2455



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE CIENCIAS

INFLUENCIA DE IMPUREZAS MONOVALENTES EN LA COLORACION F DE NACL Y KCL

T		E		S		ı		S
QUE	PARA		OBTENER		EL	TITULO		ĐE
F	1		S		Ļ	С		0
P	R	E	S	E	N	T	A	:
REBECA			SOSA		FC) N S	E	C A

México, D. F.

1989

TESIS CON FALLA DE ORIGEN





UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

CONTENTIO

INTRODUCCION

CAPITULO I .- DEFECTOS EN SOLIDOS CRISTALINOS.

- I.1. -Introducción.
- I.2. -Intersticios y Vacancias.
- I.3. -Características Principales de los Centros "F".
 - a) Modelo de caja infinita.
 - b) Modelos Recientes de creación de Centros "F".
- I.4. -Propiedades Opticas de los Centros F.

CAPITULO II.-DESARROLLO EXPERIMENTAL.

- II.1.-Crecimiento de Cristales de NaCl y KCl con Impurezas Monovalentes.
- II.2. -Absorción Optica y Absorción Atómica.
- II.3.-Irradiación de los Cristales por Medio de Rayos-X.

CAPITULO III.-RESULTADOS Y DISCUSION.

- III.i.-Curvas de Coloración de Centros F.
- III.2,-Comparación de los Resultados Experimentales Obtenidos.
- III.3.-Distorsión de la Red Debida a la Impureza Monovalente y su Relación con la Coloración F.

APENDICE

BIBLIOGRAFIA

INTRODUCCION

Debido a la creciente aplicación de los sólidos cristalinos puros o contaminados en diversas aplicaciones tecnológicas, existe una constante necesidad de un estudio profundo de éstos y su comportamiento bajo diferentes situaciones experimentales. Se sabe que las propiedades fisicas de los cristales, en particular aquellas de los halogenuros alcalinos, están ligados fuertemente a los defectos e impurezas que éstos puedan contener. Los estudios de los daños por radiación ionizante, han contribuido en forma significativa al entendimiento de la creación de los defectos y su interacción. Además, la mayoría del progreso que se ha conseguido recientemente en el area de las interacciones entre los defectos y la red cristalina, se ha debido indirectamente a los antecedentes experimentales proporcionados por investigaciones detalladas acerca de la identidad y de las proptedades de los defectos producidos por la radiación en cristales de los halogenuros alcalinos, llevados a cabo durante más de cuatro décadas.

Desde un punto de vista práctico, las investigaciones realizadas recientemente en nuevos materiales con propiedades magnéticas y eléctricas poco comunes, han generado el desarrollo de nuevas técnicas tales como la implantación de tones para producir materiales con propiedades específicas, enfatizando la importancia del entendimiento de como son alteradas las propiedades del material por la irradiación deliberada o inadvertida. De hecho, la producción de materiales con propiedades preestablecidas por el uso de la radiación, pueden volver a ser cualitativamente prácticas. Más aún, se pueden y deben probar los materiales que son y serán utilizados en el espacio o cerca de los reactores nucleares, para determinar que tanto afecta un medio hostil a sus propiedades más importantes.

En particular se ha encontrado, que bajo cierta cantidad de impurezas catiónicas divalentes en una red cristalina (de halogenuros alcalinos) las propiedades mecánicas, ópticas, eléctricas y magnéticas son modificadas en forma sensible. Por atra parte, existe cierta necesidad e interés de entender los procesos que involucran la interacción de la radiación ionizante con la materia, como los que dan origen a las curvas de producción (coloración) de centros F en sólidos iónicos.

Cuardo un cristal de un halogenuro alcalino esta expuesto a cierto tipo de irradiación, el primer efecto que se detecta es que la muestra cristalina adquiere un color caracteristico dependiente del cristal que se trate; por ejemplo, si es NaCl toma un color quartillo y si es KCl azul. Este color es debido a la presencia de un defecto conocido como centro F que se forma por el atrapamiento de electrones en vacantes de naturaleza halógena. Actualmente se ha logrado comprender rasonablemente bién algunos de los aspectos del mecanismo del crecimiento de dichos defectos el cual se divide fundamentalmente en dos elapas principales; en la primera tiene lugar un proceso de decaimiento exitónico no-radiativo que da surgimiento a los centros F y sus complementarios H. En la segunda etapa existe un proceso térmico asociado con el movimiento de los intersticiales halógenos y su subsecuente atrapamiento en los defectos, lo que al final conduce a la estabilización definitiva de los centros de color después de la irradiación.

Estos resultados han sido obtenidos fundamentalmente a partir de los estudios realisados con cristales de halogenuros alcalinos puros o contaminados con impurezas catiónicas divalentes. Los modelos teóricos actuales idiapyso han alcanzado una muy buena concordancia con las evidencias experimentales. Sin embargo, para dar una teoria definitiva del proceso de producción de centros F, es necesario llevar a cabo estudios

más sistemáticos para esclarecer totalmente algunos aspectos, como la inestabilidad térmica de las trampas intersticiales así como de la formación de las trampas mismas.

Por otra parte, respecto a las trampas, durante mucho tiempo se consideró, únicamente, a las vacancias como las trampas de los intersticiales; mientras que ahora se tiene bién establecido que estos son atrapados por el (o los) dipolo(s) I-V (impureza divalente-vacancia). Sin embargo, respecto a este último punto se presenta la incógnita de si el atrapamiento es debido a la carga electrostática de la vacancia, por atracción Coulombiana; o si el intersticio es atrapado por el Campo de Deformación (de esfuerzos) creado por el par I-V. Es obvio que en el caso de impurezas divalentes ambos mecanismos de atrapamiento existen y de hecho pueden competir para dar la estabilidad necesaria al centro F. El poder discernir cual de éstos mecanismos es el responsable del atrapamiento de los intersticiales es una tarea dificil en el caso de halógenuros alcalinos contaminados con impurezas catiónicas divalentes. A este respecto, el estudio de la formación y estabilidad de centros F en éstos cristales, contaminados con impurezas monovalentes, puede dar información sobre el mecanismo de atrapamiento preferencial ya que en este caso solamente operari el campo de esfuerzos y no la carga de la vacante aniónica.

CAPITULO I.- DEFECTOS EN SOLIDOS

I.1.-INTRODUCCION

La caracteristica principal que poseen los sólidos cristalinos es la de lener una estructura periodica y ordenada. La hipótesis de que esta regularidad interna en la estructura del cristal exista, se confirma satisfactoriamente por la manifestación de formas geométricas externas, y de los análisis de difracción de Rayos X. Sin embargo, durantes los últimos años se ha llegado a establecer que muchas de las propiedades experimentales importantes de los sólidos, no se pueden explicar sin suponer que los cristales reales contienen imperfecciones estructurales de diferentes tipos. Desde el punto de vista leórico, también se ha encontrado que el orden perfecto revelado por los anilists de difracción de rayos-X, no podrk existir jamas. El movimiento termico de los atomos que componen el sólido es, en si mismo, un tipo de imperfección en la estructura porque los átomos no stempre están en los puntos de la red en un modelo estático del cristal (de-al. Además, como se verá más adelante, pueden surgir otros tipos de imperfecciones por razones puramente termodiniamicas, es decir

cuando se eleva la temperatura del cristal. Esto tiene mucho que ver con el fenómeno de centros de color, por lo que a continuación exponemos una descripción preliminar de algunos defectos. Como antecedente para el presente estudio, los defectos más importantes son: aliones intersticiales, blaticos vacantes de la red y climpuresas².

I. 2. -INTERSTICIOS Y VACANCIAS.

Los defectos puntuales en materiales cristalinos puros, sondefectos de dimensiones atômicas que usualmente surgen de la presencia de una impureza, de la ausencia de un kiomo de la matriz ó de la presencia de un átomo de la matriz en lugares normalmente no ocupados. Estos defectos se muestran en la fig. 1. Un atomo impureza que ocupa un sitio normal de la red se le llama una impureza substitucional y un Atomo que se encuentra en los intersticios, entre los atomos de la matriz, se le llama itomo intersticial; éste puede ser una impureza o un itomo de la misma red. El que un átomo ocupe un sillo substitucional ó intersticial depende del tamaño relativo del átomo respecto al tamaño del silio. Normalmente, Atomos pequeños ocupan sitios intersticiales v **≜**tomos grandes ocupan substitucionales. Finalmente a los sitios de la red vacantes se les llama vacancias.

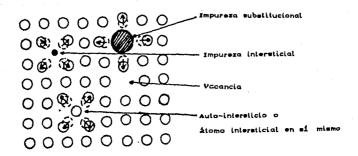


Fig. 1. -Defector puntuales en materiales cristalinos

Es bién conocido, que los cristales de los halogenuros alcalinos muestran conductividad eléctrica a temperaturas elevadas; esto también es cierto para otros cristales polares. Frenkel fué el primero que puntualizó que éste tipo de conductividad requiere de la postulación de imperfecciones cargadas móviles en los cristales reales. Los iones intersticiales y los sitios de la red vacantes son imperfecciones que tienen las propiedades necesarias para explicar el transporte de la materia que es observado en la electrólisis ó en experimentos de difusión en cristales.

•

En la fig. 2.a se muestra una representación bi-dimensional de un cristal polar que no contiene defectos. En la fig.2.b se muestra un cristal con dos tipos de iones intersticiales. Uno de ellos (*) surge cuando un catión es removido de su sitio de la red normal, mediante algún proceso y se coloca en un sitio intersticial de la red; el otro (*) surge cuando un antón es desplazado en forma similar. Cuando uno remueve un antón o un catión a una posición intersticial se crea un sitio vacante de la red correspondiente, ya sea una vacancia catiónica o una vacancia antónica. Estas imperfeciones se muestran también en la fig.2.b.

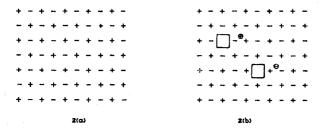


FIG. 2(a) CRISTAL IONICO QUE NO CONTIENE DEFECTOS. FIG 2(b) DEFECTOS FRENKEL CATIONES Y ANIONES CON SUS CORRESPONDIENTES VACANCIAS.

Este mecanismo de formación de defectos es llamado el mecanismo de Frenkel, y la imperfección dual -ión intersticial junto con la vacancia- es conocido como un defecto Frenkel.

Los sitios vacantes de la red en un cristal se pueden formar de otra manera, la cual no involucra la producción de iones intersiciales. La fig.3 ilustra que ambos, los cationes y los aniones son removidos del interior del cristal y se adhieren a la superficie para formar una nueva capa del cristal. Para que este proceso ocurra en forma apreciable, se deben localizar en la superficie igual número de cationes y aniones para preservar la neutralidad eléctrica; de ahi que se produzcan iguales concentraciones de vacancias aniónicas y catiónicas en el interior del cristal. Este mecanismo de producción de vacancias fué propuesto por Wagner y Schottky. La imperfección dual consistente de una vacancia catiónica y una vacancia aniónica es conocida como un defecto Schottky.



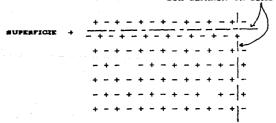


FIG. 3. - DEFECTOS SCHOTTKY

Podemos imaginar también un cristal en el cual no hay vacancias sino que contiene cationes y aniones intersticiales en proporciones estequiométricas. Pero hasta ahora no se ha encontrado un ejemplo de tales cristales.

La presencia de los defectos de Frenkel y los de Schottky en los cristales reales se puede deber a razones puramente termodinámicas. A saber, para que un cristal esté en equilibrio termodinámico a una temperatura dada, su energia libre debe tener un valor minimo. Aunque se debe ceder energia contra las fuerzas de cohesión del cristal para formar un defecto, el aumento en la entropía debida a ello es la causa de que la energia libre sea un minimo para una concentración definida de defectos a una temperatura dada. La concentración de equilibrio de los defectos se puede derivar rigurosamente de la Mecánica Estadística (ver Apendice I) pero aqui daremos un enfoque sencillo y práctico al proceso observandolo como una reacción química en donde el equilibrio está determinado por la ley química de acción de masas. A partir de un cristal ideal se puede formular la producción de defectos Frenkel como sigue:

Ion normal sitio ion en punto
en un punto + intersticial => sitio + vacante
de la red desocupado intersticial de la red

Si en un volumen unitario de cristal tenemos, $n_i = n timero$ de iones en posiciones intersticiales en equilibrio; $n_i = n timero$ de puntos vacantes de la red en equilibrio; N = n timero total de puntos de la red en el cristal ideal; y $N_i = n timero$ de posiciones intersticiales posibles, la ley de acción de masas establece:

$$\frac{(n_1)(n_2)}{(N-n_2)(N_1-n_2)} = K(\tau)$$
Ec. (1)

donde $K_{(T)}$ es la constante de equilibrio que a su vez es una función de la temperatura. El mecanismo de Frenkel requiere que $n_i = n_v$. Si la concentración de defectos es pequeña, la ec.(1) se simplifica de la siguiente manera:

$$n_i^2 = NN_i K_{(T)}$$
 Ec.(2)

Si \mathbf{z}_{i} es la energia de formación de un defecto Frenkel, entonces $K_{(ij)}$ depende de la temperatura en la forma siguiente:

$$K_{(\pi)} = \exp(-8/kT)$$
 Ec.(3)

De las relaciones (2) y (3) obtenemos para n_i:

$$n_i = \sqrt{N N_i} \exp(-8_i/2kT)$$
 Ec. (4a)

Si se toman en cuenta los cambios en el volumen que acompañan la formación del defecto así como los cambios en las frecuencias vibracionales de los iones que están alrededor del defecto, la ec. (4a) se modifica para dar:

$$n_i = \sqrt{ANN_i} \exp(-8_i/2MT)$$
 Ec. (4b)

donde A es una constante.

En forma similar se puede mostrar que para los defectos Schottky (ver Apendice):

donde n_{ν} es el número de vacancias iónicas positivas o negativas por unidad de volumen. N es el número de pares anión-catión en el cristal ideal. B es una constante y s_{ν} es la energia requerida para formar un defecto Schottky (vacancia catiónica + vacancia aniónica con n_{ν} <N).

Cuando los radios iónicos son muy grandes la energia requerida para ubicarlos en posiciones intersticiales es muy grande comparada con la que se requiere para ubicar cationes intersticialmente. Por lo tanto, se espera que normalmente se formen de manera preferente los defectos de Frenkel catiónicos que los aniónicos. En forma análoga, para un cristal dado habrá una diferencia entre la energia requerida para formar un defecto Frenkel y la que se requiere para formar un defecto Schottky. Obviamente, el tipo de defecto que predomine en el cristal será el tipo de defecto que requiera de una energia de formación menor. Los cálculos que se han hecho de la energia de formación de defectos Schottky y la de los defectos Frenkel indican que el tipo de defecto que se forma es favorecido si hay aproximadamente igualdad en tamaño de cationes y aniones, y si la constante dieléctrica y la contribución de Van der-Waals a la energia de la red son bajas; los cristales de los halogenuros alcalinos son de este tipo. Los defectos Frenkel son favorecidos cuando existe diferencia considerable en tamaños iónicos y cuando la constante dieléctrica y la energia de Van der Waals son grandes. Se han hecho calculos para & y 🐧 y los últimos valores encontrados son: 🐉 = 2.9 eV para Na 🖢 en NaCl, mientras que el valor que se calcula para 8 es de 1.9 a 2.0 eV para NaCl, KCl y KBr. Estos resultados teóricos indican que deben predominar los defectos Schottky en los cristales de los halogenuros alcalinos.

I.3. - CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LOS CENTROS F

Otro tipo de defecto que aparece en un cristal se manifiesta al ser sometido éste a diferentes tratamientos; en particular los producidos por radiación ionizante. El centro F, conocido como el prototipo de los centros de color, es un defecto que aparece en el cristal cuando éste se expone a radiación de rayos-X o fotones ultravioleta. A continuación daremos la información de como se forman los centros F.

La carga efectiva en vacancias, tones intersticiales y iones impureza de cierta valencia conduce al apareamiento o asociación de estos defectos; esa misma carga les da también la propiedad de atraer y enlazar electrones y hoyos positivos que han sido liberados en el cristal por algún mecanismo. Así, se forman igual número de electrones y hoyos. La mayoría de los electrones se recombinan rápidamente con los hoyos esto es, los electrones son replegados en los iones despojados y reconstituyen los iones normales. Si antes de esto, sucede que un electrón libre vaga cerca de un catión intersticial (o cerca de una vacancia aniónica, o cerca de una impureza substitucional catiónica de valencia mas grande que la de los

cationes de la red), este defecto cargado positivamente puede atrapar el electrón en su campo Coulombiano. Los hoyos positivos que escapan primero antes de la aniquilación, también vagan a través del cristal y son atrapados por los defectos cargados negativamente tales como las vacancias catiónicas o aniones intersticiales.

Con frecuencia, el centro formado por un electrón atrapado en un catión intersticial se refiere a un "Atomo" intersticial. Este término también se aplica al centro formado por el atrapamiento de un hoyo positivo por un anión intersticial (x intersticial + hovo positivo = xº intersticial). La designación de "Atomo" no se toma literalmente, ya que en general para los casos anteriores la distribución electrónica se traslapa en un número considerable de sitios de la red. Asi, el electrón atrapado u hoyo puede ser representado como residente en cualquier instante dado en uno de los iones de los alrededores convirtiéndolo momentaneamente en un tón de carga positiva mas grande o mas pequeña (valencia mas grande o mas pequeña) respectivamente. Las mismas consideraciones hechas a los electrones u hoyos atrapados, son aplicados a otros defectos tales como vacancias aniónicas o catiónicas o a iones impureza. La distribución de carga del electrón o del hoyo, generalmente traslapa a la de los iones que rodean al defecto a una extensión considerable. La Fig. 4 muestra diferentes formas de

representar el centro neutral (centro F) formado por el atrapamiento de un electrón en una vacancia tónica negativa en un halogenuro alcalino.

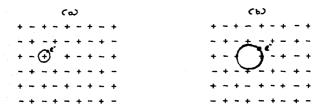


FIG. 4. -DOS FORMAS DE REPRESENTAR UN ELECTRON ATRAPADO EN UNA VACANCIA IONIGA NEGATIVA (CENTRO F). (a) UN ATOMO ALGALINO EN EL, FUNTO ADVACENTE A UN ION NEGATIVO DESAPARECIDO. (b) UN ELECTRON COMPARTIDO ENTRE LOS SEIS VECINOS DE UN PUNTO VACANTE DE LA RED.

Los centros F (electrón-atrapado) u hoyo-atrapado que se forman por irradiación de rayos-X de un cristal se pueden destruir calentando el cristal o iluminándolo con luz de la longitud de onda apropiada. Esto se explica por el hecho de que un electrón que está atrapado por un defecto cargado positivamente comprende un sistema análogo al átomo de hidrógeno. Como tal, tiene entonces varios estados excitados por lo que éste puede ser excitado por absorción de luz de la energia requerida. Con la absorción de energia suficiente, el electrón puede ser liberado completamente del defecto, en

representar el centro neutral (centro F) (=) formado por el atrapantento de un electrón en una vacancia a (ónica negativa en un halogenuro alcalino.

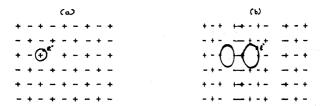
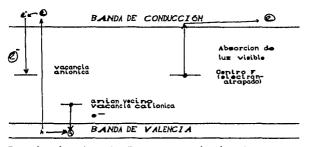


FIG. 4.-DOS FORMAS DE REPRESENTAR UN ELECTRO-CEMON ATRA-M-ADO EN UNA VACANCIA IONICA NEGATIVA (CENTRO F). (a) (0) UN A-TOMO ALCALINO EN EL PUNTO ADVACENTE A UN IOM-CI ON NICA TEVO DESAPARECIDO. (b) UN ELECTRON COMPARIDO EN-WEMNRE LO-SS SEIS VECINOS DE UN PUNTO VACANTE DE LA ALA RED.

Los centros F (electrón-atrapado) u hoy « contra cado que se forman por irradiación de rayos-X de un a cristal se pueden destrutr calentando el cristal o iluminindo totolo cora luz de la longitud de onda apropiada. Esto se explica por por el Paecho de que un electrón que está atrapado por un na dejecto cargado positivamente comprende un sistema análogo ogo al átomo de hidrógeno. Como tal, tiene entonces varios e estados excitados por lo que éste puede ser excitado por absoratorión de energy rela su ficiente, el electrón puede ser liberado completamente del elefecto, en

analogía a la ionización de un ktomo de hidrógeno. Si el electrón libre encuentra un hoyo positivo atrapado durante su migración a través del cristal, este puede caer en el hoyo y aniquilarlo. Las mismas consideraciones son aplicadas a la ionización de un centro hoyo-atrapado, seguido al cual el hoyo libre encuentra un electrón atrapado y es aniquilado. Estos procesos de formación y blanqueo (o aniquilación) de centros F y hoyo-atrapado se representan en el esquema de bandas que se muestra en la Fig. 5.



Formacion de centros : F.Y. Bestruccion de eales centros por absorcion del la Formacion del Centro DE COLOR F Y SU DESTRUCCION.

Con una brecha des la banda prohibida del orden de 10 eV, la absorción de lus en el ultravioleta vacio corresponde a la liberación de un electrón de la banda de valencia a la banda de conducción. Dado que la banda de valencia surge de los

electrones de valencia de los iones halogenuros, esto corresponde a remover un electrón de un ión halogenuro. A esta deficiencia de un electrón, se le liama "hoyo positivo" y el hoyo viene siendo como un electrón con una carga positiva. Desde un punto de vista quimico y como ya se dijo antes, un hoyo sobre un ton halógeno transforma al ión en un Δ tomo (X^- + hoyo = X^0). El término "hoyo" nunca debe ser aplicado a la ausencia de un tón de un sitio de la red; a esta entidad se le liama "vacancia".

Como tanto el electrón como el hoyo positivo son libres para principio debe moverse. en manifestarse fotoconductividad de este proceso. Por otro lado, la absorción de luz en la longitud de onda de la banda ultravioleta cercana no produce fotoconductividad. La luz de esta longitud de onda no es suficientemente energética para separar completamente al electrón y el hoyo positivo, los cuales permanecen enlazados uno a otro por atracción Coulombiana. La entidad eléctricamente neutra asi formada, es un estado excitado del cristal y puede verse como una particula libre que puede "vagar" o perderse a través del cristal, transportando energía pero sin ninguna carga eléctrica neta. El movil "particula" consistente de un electrón enlazado a un hoyo positivo es llamado un "exitón", y los estados de energía correspondientes a tal configuración son llamados los estados excitónicos.

I.3.a). - MODELO DE CAJA INFINITA.

Existen varios modelos teóricos que tratan de dar una explicación al proceso de la absorción de los centros F. La mayoria de ellos comparten una característica: en la región de la vacancia, la energia potencial se parece a la de un pozo cuadrado tridimensional. En la Fig.6 se ilustra la parte esféricamente simétrica del potencial en el punto del ión. Esto es justamente el potencial electrostático generado por los iones en el cristal, tratados como cargas puntuales. La energia potencial es constante (igual a la energia de Madelung, tipicamente de 9 eV) fuera de la distancia de los vecinos más cercanos aproximadamente a los 3 Å. A partir de ahi aumenta hasta alcansar el valor promedio de -e²/r. Esto sugiere presentar un modelo muy simple: el de un pozo cuadrado infinito tridimensional.

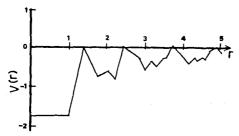


FIG. 6. -VARIACION DEL POTENCIAL ELECTROSTATICO CORRESPONDIENTE A LA PARTE SIMETRICA ESPERICAMENTE.

En este caso, el electrón que forma el centro F se asemeja al de la particula en una caja tridimensional de potencial infinito. Considerémos por lo tanto una particula que se mueve a lo largo del eje x. La energia potencial V de la particula es cero para O < x < L; y se hace infinita para $x \le O$ y $x \ge L$. Aqui se hace uso de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo:

$$\frac{d^2\varphi}{dx^2} + (2\pi/\hbar^2)E\Psi = 0$$
(6)

donde E es la energia total de la particula; en este caso la energia cinética. La solución general de la ecuación (6) está dada por:

$$\Psi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}$$
 con $k^2 = (2m/h^2)E$

Las condiciones de la frontera requieren que se satisfaga:

De la primera condición resulta que A = -B; esto permite soluciones del tipo senCkx). Aplicando la segunda condición a la frontera, se singularizan unicamente aquellas soluciones para las cuales:

senkL = 0 6 kn = $n\pi/L$ con n=1.2.3,...

Por lo tanto, las soluciones obtenidas son ondas estacionarias de la forma:

Para cada valor de n hay una función de onda ψ_n correspondiente a una energia dada por:

$$E_n = h^2 k_n^2 / 2m = h^2 n^2 n^2 / 2mL^2 \dots (8)$$

Claramente se ve que el espectro de energía consiste de niveles discretos y la separación depende de L^2 y n^2 . La constante C de la ecuación (2) se puede obtener al conocer el estado Ψ_n de la particula.

Para una particula en una caja de potencial cúbico tridimensional de lado L, las soluciones estan dadas por una extrapolación de ondas estacionarias de la forma:

 $\Psi(x,y,z) = C \operatorname{sen(nx} \pi x/L) \operatorname{sen(ny} \pi y/L) \operatorname{sen(nz} \pi z/L)$

donde nx, ny y nz son enteros ≥ 1. Los níveles de energia están dados por:

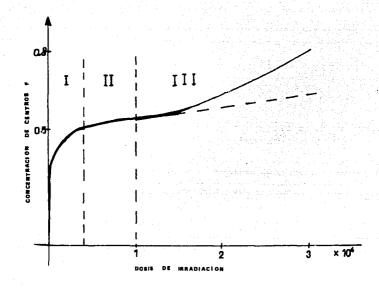
$$E_{nx,ny,nz} = (h^2 \pi^2 / 2mL^2)(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2) \dots (8)$$

La particula representada por alguna de las funciones de onda \(\pi_{\text{X}}, \pi_{\text{Z}} \) descritas arriba se dice que esta en un "estado" dado. Aqui debemos hacer notar que un nivel de energia puede corresponder a varios estados; por ejemplo, los valores enteros (1,1,2), (1,2,1), (2,1,1) todos corresponden al mismo nivel de energia, aunque estos corresponden a diferentes funciones de onda. A este nivel de energia se dice que está triplemente desenerado.

I.3.b.-MODELOS DE CREACION DE LOS CENTROS F

Un problema importante que ha enfrentado el estudio de los centros de color ha sido el mecanismo de la creación de defectos en los halogenuros alcalinos por radiación ionizante. Durante mucho tiempo se luvo en mente el proceso de un desplazamiento directo de iones por colisión elástica con los fotoelectrones. Sin embargo como veremos más adelante, la explicación del proceso real no ha sido una tarea fácil y a lo largo de los años se han venido proponiendo una variedad de mecanismos que involucran en primera instancia la conversión de la energia de excitación electrónica en una forma capáz de fabricar defectos en la red^{id,18}.

Para ello darémos primero, algunas características principales respecto a la forma de las curvas de coloración por irradiación—X a temperatura ambiente. Uno de los efectos principales de la radiación ionizante en los halogenuros alcalinos es la producción de centros F; esto es, vacancias iónicas negativas en donde hay un electrón atrapado en cada una



PIG-7 ETAPAS DE LA CURVA IFFICA DE COLORACION DE CENTROS F EN CRISTALES HALOGENUROS ALCALINOS

de ellas. No hubo demastado problema para explicar el origen de los electrones, dado que la absorción de la radiación ionizante conduce a la producción de un gran número de electrones libres, los cuales pueden ser atrapados en cualquier vacancia iónica negativa presente en el cristal, formando así un centro F. Sin embargo, la explicación del origen de las vacancias iónicas negativas o mejor aún de las "trampas" de los electrones y sus características ha sido una labor mucho más dificil.

Se entiende por curva de coloración de centros F a la evolución de la concentración de centros F o intensidad de la banda-F como función del tiempo acumulado de exposición a la radiación ionizante. Originalmente, en 1956 Gordon y Nowick⁶ identificaron algunas regiones, relativamente distintas, en el comportamiento de las curvas de coloración. Cada curva se puede descomponer en tres etapas: la etapa primaria (I) en la cual la coloración es rápida y se satura después de una exposición relativamente corta (II), y una tercera etapa (III) que surge muy lentamente y muestra signos de saturación unicamente para exposiciones muy largas. La etapa primaria varía completamente de una muestra a otra, mientras que la segunda etapa no tiene mucha influencia respecto al origen de la muestra. La etapa primaria o extrinseca se atribuyó originalmente a la población de vacancias anionicas ya existentes en el cristal, y la

segunda etapa a un proceso de creación de defectos intrinseco o cuasi-intrinseco² (Ver Fig.7).

A lo largo de las tres últimas décadas se han propuesto una gran variedad de modelos para la descripción de las curvas de coloración F, por lo que a continuación darémos una breve evolución de dichos modelos hasia la actualidad.

En el año de 1954, poco tiempo despues de que apareció el trabajo de Seitz en donde él expone un mecanismo de creación de centros F. Varley (1954a,b) propone un mecanismo de creación de defectos con bases muy diferentes a las que se conocian hasta el momento. Mientras que el mecanismo de Seitz presupone a la dislocaciones como las fuentes productoras de pares de vacancias, ya que se pensaba, que debería de haber una concentración de vacancias suficientemente grande para soportar la concentración de saturación de los centros F; Varley considera a la creación de defectos como un mecanismo de ionización multiple de un ión halógeno. Este mecanismo se resume a lo siguiente: a) un ión halógeno pierde dos o más electrones, de tal manera que queda cargado positivamente, Fig. 8a,b; b) El ión cargado positivamente se encuentra ahora en una posición altamente inestable, puesto que el potencial de red (de Madelung) requiere de la presencia de un ton negativo, por lo que es arrojado hacía una posición intersticial en un período comparable a una vibración de la red, Fig. 8c,d; y c) la subsecuente relajación estabiliza a los defectos y conduce a la captura de un electrón por la vacancia (para formar un centro F), y la captura de un electrón por el intersticial (para formar un centro H estable).

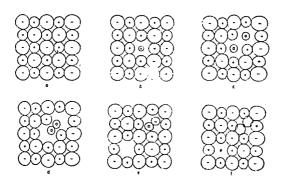


FIG. 8. -REPRESENTACION ESQUEMATICA DE LA CREACION DE DEFECTOS TIPO FRENKEL DESPUES DE LA DOBLE IONIZACION DE UN ION HALOGENO EN UNA RED HALOGENURO-ALCALINA.

Un poco después surgió la proposición de otro mecanismo pero no había recibido mucha atención. Sin embargo, este mecanismo dió pie al proceso más aceptable planteado en los

modelos actuales como se verá posteriormente. Este surgió de la examinación del mecanismo de la formación de defectos por interacción de átomos halógenos advacentes con su vecino inmediato, realizado por Williams (1962) quién puntualizó que en el caso de una sola ionización de un anión aislado, habia una probabilidad finita de desplazamiento atómico via conversión de energia potencial (electrónica) en cinética. En aquel entonces se encontraron estacios anti-simétricos que conducen a la formación de configuraciones capaces de impartir energia cinética del orden de la energia de enlace del complejo molecular Cl.. El problema consistía en que si esta energia era suficiente para producir defectos de tipo Frenkel en una cantidad suficientemente grande para que fuera notoria su observación experimental.º

El mecanismo propuesto por Hersh^o (1966) y Pooley¹⁰ (1965,1966) involucró en la producción de defectos un mecanismo de decaimiento exitónico. Estos autores presentaron su investigación en forma independiente y simultanea en el Simposto Internacional de Centros de Color en Halogeniuros Alcalinos en Urbana, Illinois (1966). Ambos basaron sus modelos respectivos esencialmente en el mismo conjunto de observaciones. El primero de ellos se basó en la aparente relación inversa entre la dependencia de la temperatura de la eficiencia luminiscente intrinseca sobre la excitación

fundamental y la producción de los centros F y V_2 en KI. Experimentalmente se conocía que la luminiscencia intrinseca producida por la recombinación del excitón disminuía rapidamente entre 363°K y 383 °K mientras que en éste mismo rango de temperaturas la producción de centros F y V_2 aumenta rapidamente. Abajo de 90°K la producción de centros F es muy pequeña y a 4°K ésta es únicamente de 0.02 de la de KCI.

La segunda aportación importante en aquel entonces, fue la observación de que los centros F podían ser creados en Kl por absorción de luz ultravioleta cerca de la absorción fundamental y la dependencia de la temperatura de la creación de centros F es la misma que para rayos-X. Hersh puntualizó que estos factores experimentales podrian tomarse en cuenta en términos de algún tipo de proceso excitónico; y se consideró que:

$$I_2^* = \longrightarrow I \text{ (intersticial)} + V \text{ (vacancia)} + I^- + e$$

donde I_{2}^{\bullet} es el exitón cuyo decaimiento no-radiativo provee la energia para dicho proceso.

Pooley¹⁰ (1966) hizo una proposición muy similar basada sobre la misma información experimental, explicando el hecho de que los defectos pueden ser creados en producción apreciable por fotólisis ultravioleta y que la creación de centros F aumenta abruptamente en el mismo rango de temperaturas donde existe una pérdida drástica en la eficiencia lumíniscente. Propuso entonces que la energía alcanzada durante la recombinación exitónica vía el modo no radiativo podría ser usado para iniciar el remplazamiento de colisiones en el arreglo compacto de l⁻ en la dirección <110>.

Pooley plantea su modelo en forma matemática de la siguiente manera: Si las transiciones no radiativas conducen a la producción del centro F entonces la razón de la producción de centros F está dada por:

$$\frac{dF(T)}{dt} \propto \frac{R(T)}{1 + R(T)}$$

donde RCT) es la razón de probabilidad de la transición no-radiativa, a la radiativa.

Posteriormente, surgieron una serie de estudios

relacionados principalmente con la dependencia de la producción de centros F. con la temperatura. IE. Kotomin, I. Fabrikant e I. Tale (1977), y K.J. Kao y H.H. Perlman (1979). Además, de la dependencia con la temperatura, en estos trabajos se manifiestan ciertas evidencias de que en muestras cristalinas de KCl dopadas con Eu²⁺ (impureza divalente) se produce una asociación de dipolos Impureza-Vacancia (I-V), la cual es destruída al recibir la radiación y la impureza divalente se convierte en impureza de un sólo estado de valencia produciendo asi, además de los centros F, una banda de absorción de Eu*; la cual aumenta en la medida que aumenta la dosis de radiación v disminuye (o se destruye) la concentración de Eu²⁺. A partir de entonces se habla de trampas de electrones que no conducen necesariamente, pero que si intervienen en el proceso de la creación del centro F. de aqui que en los modelos posteriores sea involucrado dicho fenómeno.

En 1979 G. Guillot y A. Novailhat¹⁸ proponen un modelo en el que la razón de creación de los centros F es una función de varios proteccor secundad con la tenado lermicamente que tienan lugar después de un evento primario que es la creación de pares de Frenkel: Un intersticio halógeno libre puede recombinarse ya sea con un centro F o puede ser atrapado en algún lugar

desconocido. Las investigaciones cuantitativas de sus resultados son planteadas en un par de ecuaciones basadas en el tratamiento de reacciones de difusión limitada de Waite¹⁴:

$$\frac{dt}{dt} = \alpha \epsilon - \sigma_{p} i F - \left(\frac{dt}{dt}\right) s$$

$$\frac{dF}{dt} = \alpha \epsilon - \sigma_{p} i F$$

$$c = \frac{V_f}{ed}$$
 $c = factor de densidad de energia$ almacenada sobre un cristal irradiado con electrones. Varia entre 10^{10} y 5×10^{21} eV/cm².

donde i y F son las concentraciones de intersticiales halógenos libres y centros F; a es la eficiencia del evento primario (eficiencia de la producción de pares de Frenkel), y σ_{p} es el coeficiente que fija la sección de recombinación entre intersticiales y vacancias (σ_{p} =4nR $_{p}$ D con R_{p} igual al radio de reacción y D es el coeficiente de difusión intersticial). En éste modelo esta involucrado también un mecanismo de nucleación inhomogénea de intersticiales (V4) (di-intersticiales) en la proximidad de algunas impurezas residuales. Los aglomerados de centros V4 son originarios de la interacción entre un intersticial móvil y otro atrapado temporalmente por una

impureza.

La razón de producción de los daños creados por radiación ionizante en los halogenuros alcalinos es afectada seriamente por la naturaleza de las reacciones secundarias, las cuales ocurren después de la producción primaria de los centros F y H, que auimicamente son equivalentes a los atomos halógenos intersticiales. Por otro lado, los diferentes t i pos impurezas juegan un papel muy importante en estas reacciones. las cuales actúan como trampas de los centros H. Estos se mueven en la red a muy bajas temperaturas. Es por ello que para los inicios de la decada de los 80°s, la atención estubo dirigida hacia los mecanismos en los que las impurezas influían fuertemente en la producción de centros F (en irradiaciones hechas a temperatura ambiente). Se reconoció que las impurezas cationicas divalentes substitucionales, tenían un efecto importante en el crecimiento de las curvas de dichos centros. Como consecuencia de ésto último resulta un rapido crecimiento de la primera etapa de producción de los centros F. mientras que la última etapa, correspondiente a las grandes dósis de irradiación, cambia en forma muy complicada ya que está relacionada con las reacciones secundarías del proceso.

Por otra parte, a partir de los estudios sobre mediciones ópticas, de la conductividad térmica y de microscopia electrónica en cristales irradiados ya se ha aceptado, que los aglomerados de halógenos intersticiales son el producto preferente para altas dósis de irradiación. La presencia de impurezas catiónicas divalentes altera significativamente el tamaño y el número de aglomerados, lo cual sugirió a partir de alli un proceso de nucleación heterogénea.

Sobre la base anterior Comins y Carragher¹⁵ proponen una nueva explicación de las relaciones observadas experimentalmente entre el crecimiento de defectos y la concentración de impurezas catiónicas divalentes. Dichos autores incorporan en su modelo la estabilización de los centros H y los defectos halógenos di-intersticiales en los dipolos V-I (vacancia-impureza) o agregados de dichos dipolos, las ecuaciones cinéticas de éste modelo son:

$$\frac{df}{dt} = p - \sigma i f \tag{1}$$

$$\frac{dt}{dt} = \rho - \sigma i f - \sum_{j} \alpha_{ij} i (n_{ij} - n_{ij} - n_{ij})$$

$$+ \alpha_{2} i n_{1} - k_{1} n_{2} - 2k_{1} n_{2}$$
 (2)

$$\frac{dn_{ij}}{dt} = \alpha_{ij} t (n_{Dj} - n_{2j} - n_{ij}) - \alpha_{2j} t n_{ij} - k_{ij} n_{ij}$$

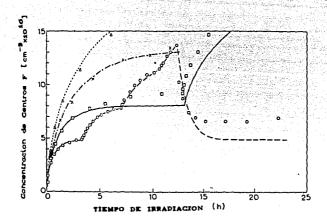
$$\frac{dn_{2j}}{dt} = \alpha_{2} t n_{ij} - k_{2j} n_{2j}$$
(4)

$$f = i + \sum_{i} (n_{ij} + 2n_{2j})$$

donde p es el factor de crecimiento, los centros H (denotados por i) son móviles o libres y pueden ser atrapados por los dipolos I-V o por los agregados dipolares en una configuración f para formar los centros del tipo $H_{\rm D}$ (denotados por n_{ij}) o en forma de trampas de los defectos halógenos di-intersticiales, (denotados por n_{ij}).

En este modelo se incorpora la estabilidad de los centros H y los defectos halógenos di-intersticiales en los dipolos I-V (impureza-vacancia) o en los agregados de tales dipolos, así como los mecanismos de desatrapamiento intersticial. Las soluciones numéricas y las aproximaciones analíticas de las ecuaciones reproducen la dinâmica del crecimiento del centro F y los factores dependientes de la temperatura encontrados en los estudios experimentales. Aqui se hace notar que los diferentes tipos de impurezas juegan un papel muy importante en estas reacciones dado que actúan como trampas para los centros H, los cuales son movibles a muy bajds temperaturas.

En éste trabajo se concluye que los detalles precisos de los procesos de desatrapamiento no son claros, dado que se puede involucrar la captura de los electrónes por los defectos di-intersticiales atrapados. El modelo establece distintas analogias entre el rapido decaimiento de los defectos durante la irradiación en el que ocurren las recombinaciones entre los centros intersticiales y las vacancias; en forma semejante a los efectos que ocurren durante los experimentos de blanqueo óptico con luz en el rango de la banda F. Aqui los centros F electrones los cuales predominantemente por los centros V_2^m , ocurriendo un decaimiento mutuo de estos defectos complementarios. Finalmente, manifiesta el interés por la dependencia de la cuasisaturación de los centros F con la intensidad y reproduce los cambios reversibles en la concentración de saturación con los cambios en la intensidad de la irradiación. En la fig.9 se muestran algunos de los resultados predichos por este modelo y su ajuste con las evidencias experimentales.



CENTROS KCl. O:crecimiento ydecaimiento centro irradiado gecuencialmente 201 299. 258, cristal centro para un irradiado K; X:crecimiento del centro F para un cristal C Acrecimiento centro para uncristal irradiado representan al. crecimiento teorico Los cristales A,B,C y D respectivaments.

Comins y Carragher hacen notar que su trabajo tiene ciertos factores en común (y ciertas diferencias en detalle) con el modelo de Aguilar et al, propuesto simultaneamente; sin embargo el modelo de Aguilar considera grandes concentraciones de impurezas y grandes dósis alcanzando a delinear la región III en la producción de los centros F complementando el estudio de Comins y Carragher, que sólo trabaja sobre la primera y segunda etapas.

Siguiendo esta linea de pensamiento han surgido un gran número de procesos de creación de centros F. Sin embargo, aunque el proceso primario de daños por radiación ionisante en los halogenuros alcalinos parecía ser un simple mecanismo de ionización que involucraba un decaimiento de exitones no-radiativo, la cinética de la coloración F en realidad tiene un comportamiento más complejo. En particular a temperatura ambiente (RT). La mayoría de los modelos discutidos en la literatura, atribuyen lo anterior a procesos inducidos térmicamente involucrando intersticios. Para 1981 M. Aguilario el al. proponen un modelo de Nucleación Heterogénea, ya que el modelo que suponian con anterioridad de Nucleación Homogénea de cúmulos intersticiales a través de la agregación de intersticio en intersticio, tenia una serie de fallas como las siguientes: i) se predice que el número de cúmulos intersticiales debia ser mas pequeño y su tamaño mas grande para muestras dopadas que para muestras puras. Los trabajos de Hobbs¹⁷ hechos por medio de microscopia electrónica difieren de estos resultados; y sugirieron, desde entonces, que un modelo de nucleación heterogénea seria más apropiado. Y (1) No se toma en cuenta la estabilidad térmica de los diferentes centros intersticiales.

M. Aguilar¹⁶ y colaboradores plantem un rem nuevo modelo suponiendo nucleación heterogénea tomando en c=3 cuenta, de la forma más simple posible, la inestabilidad tézètetemica de las trampas intersticiales. A diferencia del modelo oi lo anterior la agregación de intersticios libres ahora se consionesidera que toma lugar en sitios específicos, los cuales deben es exestar associados con impurezas en la gran mayoría de los casos. Se supone que estos sitios de atrapamiento son no-saturables exes, i.e. todos ellos tienen habilidad de crecer hasta ser granterandes cúmulos después del atrapamiento intersticial sucesivo. Asia lambién, al modelo supone que en el proceso de agrupamiento con se forma un centro intersticial muy inestable y de corla vida, veza, el ceual, es el responsable de la región plana de transición non (elapea dos) entre la etapa primaria de crecimiento (1) y la pela elapea final (III).

Las bases fisicas constan de un evento primar purario, mesdiante el cual la irradiación genera pares de Frenkel, ... centros f y halógenos intersticiales. El proceso secundario de endeterminaria la coloración f estableciendo el destino de aquelli-los desfectos iniciales. La idea básica del modelo es considerederar que las impurezas u otros defectos iniciales son trampas efenteciones, las cuales capturan y forman sucestimamente económ, no contrator entre el contrator el

El attapantamio de estas intersticios conduce a la estabilización de su pareja, el centro F, el cual puede ser detectado después de la irradiación.

Este modelo ignora fenómenos tales como la formación de centros de color cargados (F^+ y F^-) así como de centros complejos de tipo F: H, R, N \supset colot des. Además, la etapa que es relativamente plana Cetapa de saturación), esto es la etapa intermedia entre las etapas I y III, sugiere que un centro intersticial muy inestable está bloqueando el proceso de aglomeración intersticial por radiación inducida y esta impidiendo la formación de los agregados más estables.

Este modelo se representa en forma matemática con seis ecuaciones diferenciales linerales, las cuales involucran las concentraciones de los centros F (f), de los intersitcios libres F (i), de las trampas vacias F (so y los correspondientes centros intersitciales después de la captura, de un halógeno intersitcial F (so y), de dos F (so y) o más agregados de centros F (a). El cambio con respecto al tiempo de la concentración de estos cæntros está dado por el siguiente conjunto de ecuaciones:

$$\frac{df}{dt} = g - \sigma i f \tag{1}$$

$$\frac{dt}{dt} = g - \sigma i s_0 - \sigma i s_1 - \sigma i s_2 + a s_2 - \sigma_a i a - \sigma i f$$
 (2)

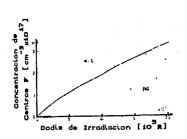
$$\frac{ds}{dt} = -\sigma(s)$$
 (3)

$$\frac{ds_2}{dt} = \sigma i s_1 - \alpha s_2 - \sigma i s_2 \tag{5}$$

$$\frac{da}{dt} = \sigma i s_{2} \tag{6}$$

donde σ representa la sección de captura la cual se ha considerado igual para todas las trampas de los intersticiales. Para los agregados A, la constante de dicha captura σ_a se supone que es proporcional a la superficie del aglomerado. Esto implica que $\sigma_a^{=n}$, donde n_a es el promedio de intersticiales por aglomerado. En la figura 10 se ilustra uno de los

resultados de este modelo, para el caso en el que $\alpha=0$; lo que significa que todos los centros son muy estables. La curva de coloración-F, es simulada por computadora y corresponde a los siguientes parametros: $g=10^{10}$ cm $^{-3}s^{-1}$, $\sigma=10^{-14}$ cm $^{3}s^{-1}$ y $s_{0}=10^{15}$ cm $^{-3}$. Posteriormente verémos que este tipo de curva se manifiesta en varios de nuestros resultados experimentales.



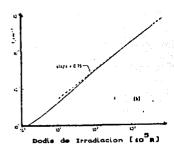


FIG. 10.-(G) CURVA DE COLORACION F SIMULADA POR COMPUTADORA

PARA EL CASO CI-O (TODOS LOS AGREGADOS SON ESTABLES). (b)

ANALISIS LOGILOS DE LA CURVA, MOSTRANDO UNA DEPENDENCIA
APROXIMADA DE CO. 75.

Otro resultado importante obtenido por Aguilar en su Hodelo es que las tres etapas observadas en la curva experimental aparecen claramente en la curva simulada por computadora tal como se puede observar en la figura 11.

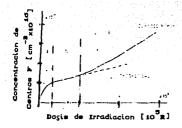




FIG. 41. -(α) SIMULACION POR COMPUTADORA DE LA CURVA DE COLORACION-F PARA α =5 g^{-1} , S_{-} =10¹⁷ Y g=10¹⁵ S_{-} (GORRESPONDE APROXIMADAMENTE A do 000 R/min). (b) CURVA DECUCIORACION EXPERIMENTAL PARA NGCL IRRADIADO A LA MISMARAZON DE DOSIS.

Entre otros resultados importantes que surgió al tratar de caracterizar las curvas de coloración en muestras dopadas con impurezas divalentes, esta el hecho de que la concentración de los centros F en la primera etapa es proporcional a la raiz cuadrada de la concentración de los cationes divalentes introducidos en el cristal. Esta es una evidencia experimental corroborada por una gran cantidad de investigadores y es un resultado de la mayoría de los modelos propuestos; en particular, el modelo de Aguilar predice esta relación para halogenuros alcalinos dopados, como una consecuencia del blanqueo térmico del centro intersticial S₁. Lo cual muestra evidentemente que las vacancias libres no son las responsables

fundamentales del atrapamiento de los intersticiales durante la etapa I.

En 1984 S. Ramos et al¹⁹, presentaron un modelo para la producción de centros F en los halogenuros alcalinos dopados con impurezas catiónicas divalentes que pueden cambiar su estado de valencia al ser sometidos a irradiación ionizante. En éste modelo se supone también que la producción de centros-F inducidos por radiación en los halogenuros alcalinos, involucra dos mecanismos: (1) Un evento primario el cual, a través de un proceso de decaimiento exitónico no radiativo, da surgimiento a los centros F v sus complementarios H. v (2) un proceso térmico asociado con el movimiento de los intersticiales halogenos (H) y su subsecuente atrapamiento en los defectos, lo cual conduce a la estabilización definitiva de los centros de color después de la irradiación. Respecto a este último punto, mucho tiempo se consideró que en los cristales de los halogenuros alcalinos dopados con impurezas metálicas divalentes (H2+) las trampas fundamentales para los defectos móviles halógenos eran las vacancias catiónicas aisladas introducidas en el cristal para preservar la neutralidad de la carga. Esta idea surgió principalmente al observar que la cantidad de coloración (n_) de la primera etapa era proporcional a la raiz cuadrada de la concentración de impurezas divalentes. Sin embargo, en la actualidad se han obtenido una gran cantidad de evidencias experimentales que muestran que los dipolos (I-V) impureza vacancia, cada uno constituido por la impureza H²⁺ y una vacancia catiónica vecina, actúa como la trampa dominante para los defectos H.

Hotivados por estas evidencias, dichos autores desarrollaron recientemente un modelo en el cual fue incorporado un proceso de nucleación heterogenea y el entendimiento actual de la naturaleza del atrapamiento de los centros intersticiales. En este modelo se considera a los dipolos I-V o agregados dipolares aislados como las trampas fundamentales para los intersticios halógenos.

Las hipótesis plantesdas en este modelo son las mismas que emplearon M. Aguilar, et al en su modelo, es decir: (1) la captura de un defecto intersticial halógeno (H) por la trampa dipolar I-V que existe desde el inicio produciendo un centro S_i , lo cual es responsable del crecimiento de los centros F, esto es de la etapa I de la curva de coloración. Y (2) el atrapamiento de un intersticio adicional por S_i genera un nuevo centro (S_2) cuya estabilidad es menor que la del S_i . Sin embargo, el atrapamiento de uno o más intersticios por S_2 convierte ese centro en un agregado denominado centro M

estable, el cual es responsable del crecimiento en la etapa
III.

Por otro lado, otra forma en la cual estos dipolos pueden variar es a través de la captura de electrones libres durante el proceso de la irradiación para llegar a tener los estados H[†] o H^O. Se supone que éstos ultimos estados tienen otras capacidades de atrapamiento de intersticiales que las que tienen los H²⁺. En el modelo también esta incluida la posibilidad de captura de un hoyo por éstos estados reducidos, eso les permitiria regresar a su estado original H²⁺. Con estas suposiciones básicas, Ramos et al postulan un conjunto de diéz ecuaciones diferenciales lineales, las cuales son mostradas a continuación:

$$\frac{df}{dt} = g - \sigma_0 f t ,$$

$$\frac{di}{dt} = g - \sigma_0 i (f + s_0 + s_1 + s_1 + n_a^{2/8} a) + \beta s_1 + \alpha s_2 ,$$

$$\frac{ds}{dt} = - \sigma_0 i s_0 + \beta s_1 - b_2 + s_0 e + b h m^4 ,$$
(3)

 $\frac{1}{dt} = -\sigma_0 i s_1 + \sigma_0 i s_0 - \beta s_1 + \alpha s_2$

(4)

$$\frac{ds}{dt} = \sigma_{0} i s_{1} - \sigma_{0} i s_{2} - \alpha s_{2} , \qquad (5)$$

$$\frac{da}{dt} = \sigma_{0} i s_{2} , \qquad (6)$$

$$\frac{dm}{dt} = e(b_{2} + s_{0} - b_{+}m^{+}) + bh(m^{0} - m^{+}) , \qquad (7)$$

$$\frac{dm^{0}}{dt} = b_{+}em^{+} - bhm^{0} , \qquad (8)$$

$$\frac{de}{dt} = \rho - e(b_{2} + s_{0} + b_{+}m^{+} + \sigma_{0}h) , \qquad (9)$$

$$\frac{dh}{dt} = \rho - h(b(m^{+} + m^{0}) + \sigma_{0}e) , \qquad (10)$$

donde f, i y s_0 representan la concentración de centros F, intersticiales libres y trampas vacias, respectivamente; s_1 , s_2 y a representan a las concentraciones de los centros intersticiales ya mencionados. En las figuras 12 y 13 se muestran las curvas de coloración F y la evolución de la concentración de los estados de valencia de M^{2+} , M^{+} y M^{0} , así como los electrones y los hoyos libres en función del tiempo de irradiación, simuladas por computadora.

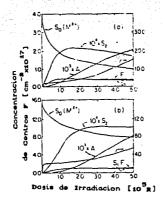


FIG. 12. - EVOLUCION DE LA CONCENTRACION DE DIFERENTES TRAMPAS RESPECTO A LA DOSIS DE IRRADIACION SIMULADAPOR COMPUTADORA , PARA LA RAZON DE p/g=500 Y PARA LAS CONCENTRACIONES DE IMPUREZA: (a) = 800 M = 20 M (b) = 12 = 8

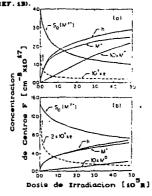


FIG. 19. - EVOLUCION DE LA CONCENTRACION DE LOS ESTADOS DE VALENCIA M²⁺, M⁺ Y M⁰, SIMULADAS POR COMPUTADORA, ASI COMO LA DE LOS ELECTRONES Y HUECOS LIBRES EN FUNCION DEL TIEMPO DE IRRADIACION CORRESPONDIENTE A LOS MISMOSPARAMETROS EMPLEADOS PARA LA OBTENCION DE LAS CURVAS DELA FIG. 12: (NEF. 18).

Algunos de los efectos encontrados por J. Rubio 19,20 el al en los halogenúros alcalinos como NaCl, KCl, KBr y KI dopados con Eu²⁺ o Pb²⁺ e irradiados con rayos-X, a temperatura ambiente son los siguientes: (a) se reduce el número de dipolos (I-V) aislados (b) aumenta el número de electrones atrapados (c) cambia el estado de valencia de los iones impureza divalentes y (d) aumenta la razón de agregación de dipolos.

Con el mismo lineamiento. J. Rubio O. y colaboradores consiste en que la curva de coloración para una muestra altamente de coloración para una muestra que no se había explicado; el fenómeno consiste en que la curva de coloración para una muestra altamente dopada puede cruzar a aquella que está dopada ligeramente después del crecimiento inicial, de tal manera que se alcanza más coloración durante la etapa dos de la curva de crecimiento de tapa de crecimiento de tapa dos de la curva de concentración de tapa de crecimiento de los centros F para las concentraciones más bajas.

Las ideas bàsicas de éste modelo están expresadas en un conjunto de diez ecuaciones diferenciales lineales, como en el modelo super en par en fondes el al pero con exigunas coricciones; las cuales promueven una nueva explicación a la relación de n_{eo}que es proporcional a la raiz cuadrada de la concentración de impurezas. A continuación mostramos dichas ecuaciones.

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = g - \sigma t f \tag{1}$$

$$\frac{dt}{dt} = g - \sigma t(f + s_0 + s_1 + s_2 + n_0^{2/3} \alpha) + \beta s_2 + \alpha s_2 - \sigma t(\rho_0 + \rho_1 + \rho_2) + \gamma \rho_1 + \eta \rho_2$$
 (2)

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = -\alpha i s_0 + \beta s_i - c_i (s_0^2 + s_0 \rho_0) \tag{3}$$

$$\frac{\mathrm{d}s_{i}}{\mathrm{d}t} = -\sigma t s_{i} + \sigma t s_{0} - \beta s_{i} + \alpha s_{2} \tag{4}$$

$$\frac{ds}{dt} = \sigma i s_1 - \sigma i s_2 - \alpha s_2 \tag{6}$$

$$\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t} = \sigma i s_2 \tag{6}$$

$$\frac{d\rho_0}{dt} = -\alpha i \rho_0 - \gamma \rho_i + \frac{c}{2} (s_0^2 - 2s_0 \rho_0)$$
 (7)

mencionado. Como var ios investigadores desarrollado modelos teóricos para la producción del centro F en cristales de los halogenuros alcalinos dopados con iones de impureza divalentes (H2+). En todos estos modelos incorporado un proceso de nucleación heterogénea entendimiento actual de la naturaleza del atrapamiento de centros intersticiales. Las soluciones numéricas de ecuaciones cinéticas involucradas en estos modelos, concuerdan cualitativamente bién con los factores más importantes de los efectos determinados experimentalmente, para la radiación con rayos-X y rayos-Y en el tipo de cristales mencionados. En algunos casos se ha alcanzado una concordancia semicuantitativa entre el modelo y el experimento, como se puede ver en figura 14, donde se muestra entre otros efectos, el del cruce las curvas de coloración para muestras altamente dopadas (curvas 3 y 4).



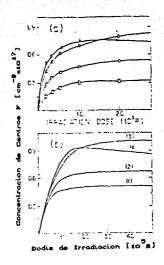


FIG. 14. - (a) EVOLUCION DEL NUMERO DE CENTROS FORDUCIDOS EN FUNCION DE LA GONCENTRACION DE IMPUREZASFARA EL SISTEMA CLS: (REF. 14). DE CAMBO O COMBO O COMBO

De éste breve resumen, podemos ver que hay una gran cantidad de estudios tanto teóricos como experimentales en relación a la Cinética de la Coloración F en halogenuros alcalinos dopados con impurezas divalentes; sin embargo, aunque

ya se tiene una teoria bastante avanzada aun no hay una explicación definitiva y clara de los fenómenos involucrados en dicho proceso. En particular, el mecanismo de atrapamiento de los intersticiales es uno de los efectos (entre otros) que no han tenido mucha atención y que sin embargo, no se tiene bién esclarecido si el atrapamiento de los intersticiales es debido al campo de deformación creado por el par impureza-vacancia en relación al tamaño de la impureza divalente o es únicamente el efecto de la atracción coulombiana entre la carga de la vacancia y el intersticial. Hás aún, se ha reportado que para impurezas iónicas alcalinas tales como Li o Na en KCl no muestran cambios de valencia permanentes, aunque hay algunas bandas transitorias en el infra-rojo que han sido atribuidas al atrapamiento temporal de electrones por dichos iones. Este comportamiento està intimamente relacionado a la localización de los niveles de energia de la impureza sobre la estructura de la banda del cristal. El cálculo riguroso de ésta localización es desde luego un problema muy complejo y se han desarrollado un gran número de métodos teóricos; desafortunadamente éstos métodos han sido aplicados pocas veces en éste tipo de impurezas sobre los halogenuros alcalinos10.

En vias de aportar mayor información acerca del mecanismo de atrapamiento intersticial realizamos el presente trabajo, en el cual llevamos a cabo una serie de experimentos de coloración

en halogenuros alcalinos dopados con impurezas monovalentes, en forma sistemática y de acuerdo con lo ya realizado para impurezas divalentes en halogenuros alcalinos para poder realizar alguna comparación. Especificamente, se obtuvieron las curvas de coloración F para cristales de los halogenuros alcalinos NaCl y KCl dopados con diferentes concentraciones de impurezas monovalentes (K, Li y Na) para observar su configuración y se analizan dichas curvas en función del tamaño de impureza; además de llevar a cabo la comparación de estos resultados con lo ya obtenido en halogenuros alcalinos dopados con impurezas divalentes.

I. 4. - PROPIEDADES OPTICAS

La causa de la coloración de los cristales de halogenuros alcalinos es la invección de electrones o su exposición a la radiación ionizante (rayos X, rayos y). Esta coloración se manifiesta por una banda de absorción en la región del visible del espectro electromagnético tal y como se muestra en el espectro de la Fig. 15. En dicho espectro se eliminan los ejectos de la reflexión superficial y la absorción natural del cristal; ésta ultima, en la región del espectro es muy pequeña. Todos los halogenuros alcalinos son transparentes en la región visible del espectro. Del lado del infrarojo ocurre la absorción debida a los defasamientos de vibraciones de los iones positivos y negativos. Del lado del ultravioleta, la otra orilla del espectro, la absorción se debe a las transiciones de interbandas y a la creación de exitones; pero ésto ocurre lejos de la región de interés que es la región visible del espectro electromagnético.

El espectro de absorción óptica se obtiene cuando se hace pasar luz a través del cristal coloreado, la relación de la intensidad de la luz que sale I(x) del cristal en función del espesor x esta dada por:

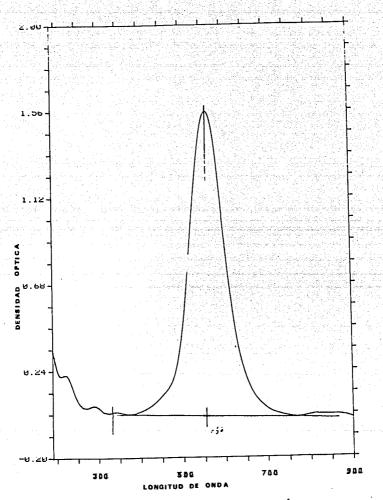


FIG.15. - ESPECTRO DE ABSORCION DEL SISTEMA KCI: Na $^+$ (25 p.p. m.) PARA UNA DOSIS DE 300 MINUTOS DE IRRADIACION.

$$I(x) = I_0e^{-\alpha x}$$
(9)

donde I_{α} es la intensidad de la luz incidente y a es el llamado coeficiente de absorción. Si despejamos a de ésta ecuación tenemos:

$$\frac{I(x)}{l_0} = e^{-\alpha x}$$

luego

$$-\alpha \times \log a = \log \left[\frac{I(x)}{I_0} \right] \qquad \dots (10)$$

v entonces

$$\alpha = -\frac{1}{\log \bullet} \left[\frac{\log I(x)/I}{x} \right]$$

pero log $\left\lceil \frac{I(x)}{I_0} \right\rceil$ es la altura de la banda F y està definido como la Densidad Optica (O.D.), la cual es negativa dado que $I(x) \ll I_0$. Por lo tanto el ccoeficiente de absorción esta expresado por:

A esta banda que es la de mayor absorción se le conoce como la banda F. a la cual se le describe como una curva en forma de campana, puesto que hasta el momento, no se ha encontrado una descripción analitica completamente satisfactoria. Los parámetros que uno puede determinar con esta banda son: la longitud de onda λ_m a la cual se obtiene la absorción máxima o la energia em; así como los puntos extremos al rojo er y al violeta ev en donde la absorción es la mitad del valor máximo lo que define el ancho de la banda a la mitad de la altura. Los centros F se pueden formar en todos los halogenuros alcalinos. De aqui que haya tablas de valores de los parámetros anteriores para cada uno de los diferentes compuestos. Para los halogenuros que manejamos en éste trabajo, estos valores son: Am (6 sm) para el NaCl 465mu (6 2.67eV), para el KCl 563mu (6 2.20eV) y para el LiCl 385mu (6 3.22 eV) a temperatura ambiente. Obviamente, estos valores han ido sufriendo algunas modificaciones que han sido consecuencia de la obtención de datos más precisos".

Nay una gran cantidad de trabajos que determinan el valor de em que al promediarse delimitan su intervalo de error. Sin embargo, Hollwo² fué el primero en reportar una relación entre em y un parámetro del cristal que es el inverso del cuadrado de la distancia interiónica, a. Los datos que obtuvo se acoplaron bastante bien a una relación empirica muy simple descubierta

por él

(para una estructura de NaCl)

Ivey encontró una ecuación con un ajuste ligeramente mejor:

$$\epsilon_m \ [eV] = 17.6 \ a^{-1.84}$$

(para una estructura de MaCl)

Estas relaciones no se aplican a las sales de cesio, ya que tienen una estructura cristalina diferente. El exponente de la distancia interiónica es del orden de 2.5 en lugar de 1.8. Al usar el método de minimos cuadrados para tratar los datos de Mollwo, la curva que mejor se ajusta es:

.....(12)

mientras que el mejor ajuste para los datos del trabajo de Rabin y Klick es de 13.8 a^{-1.8d}. Otros autores han llevado a cabo estudios similares, variando la composición de las muestras y todos estos datos obedecen rigurosamente una relación de Mollwo-Ivey aunque la concordancia no sea perfecta.

Smakula ha indicado que las desviaciones a la relación de Hollwo-luey son sistemáticas, lo cual muestra que em no esta determinada únicamente de la distancia intre los vecinos más cercanos.

Finalmente, una relación que juega un papel muy importante en el análisis de las propiedades de los centros F, es la establecida entre la medida de la absorción y la concentración de centros F, la cual se le conoce como la ecuación de Smakula. Utilizando la Teoria de Dispersión, Smákula encontró una relación muy simple entre la densidad de los centros absorbedores ópticamente activos y el coeficiente de absorción de la banda correspondiente:

$$m_p = 1.31 \times 10^{47} \frac{n}{(n^2 + 2)^2} \text{ H observe por cm}^2 \dots (13)$$

donde f es la constante de fuerza del oscilador, n es el indice de refracción, amax es el coeficiente de absorción en cm⁻¹ medido en el máximo de la curva de absorción y N es el semiancho de la banda en eV. La constante de proporcionalidad (1.3ixi0¹⁷) en general proviene de la caracterización teórica de la forma de la banda F de absorción. Esto es, el producto a max N, en escencia es dependiente de la temperatura pero es

proporcional al "area" bajo la curva de absorción -es decir a la faculdo, o bién la faculdo (ver ec. 15)- en donde la constante de absorción ya no es dependiente de la temperatura. Ahora, si ésta integral se resuelve para una curva de tipo Lorentziana el factor de proporcionalidad resulta ser de 1.31x10¹⁷, pero si ésta integral se resuelve para una curva Gaussiana dicha constante es sustituida por el valor 0.87x10¹⁷.

TABLA I. - "F" PARA KCI A RT.

M& Lodo	" <i>‡</i> "	Experimentadore:
Cond. Electrica	0.9	Stasiw
Quinico	0.81	Kleinschrod
Quinico	0.91	Doyle .
Quinico	1.17	Scott
Conversión F+F'	0.81	Pick
EPR	0.85	Silsbee
Prop. Magnéticas	0.66	Rauch and Heer

O. Stasty, 05tt. Nachr., p. 20t (1982).

Kleinechrod, F. G. , Ann. Physik 27, 97 (1996).

Doyle, W. T. Phys. Rev. 111, 1072, (1956).

Scott, A. B. and Hill, M. E., J. Chem. Phys. 28, 24 (1958).

Pick, H., Ann. Physik, 31, 8d8 (1988).

Milabee, R. M. Phys. Rev. 103, 1075 (1950).

Rouch, G. J. and Heer, G. V., Phys. Rev. 105, 914 (1957).

Existen varios métodos para medir la constante de fuerza del oscilador, en la tabla I se resumen algunos resultados que como puede observarse varian de método a método debido a que en algunos casos (Pick, Kleinschrod por ejemplo) requieren en sus experimentos una banda-F "pura", mientras que algunos de los

on otros valores pudieron haber sido obtenidos sobre un espectro (de mayor resolución) en donde ademis de la banda-F aparece una o mis bandas del lado derecho de la banda-F. Los valores de "f" op que reportamos aqui (Tabla II) son los obtenidos por Heer y colaboradores²⁸, quienes usaron una técnica magnética.

TABLA. II. - "4" A PARTIR DE PROPIEDADES HAGNETICAS

Cristal	"4"
•KCI	0.65 -
KBr	0.71°; (0.85)°
KI	0. 45ª
NaC L	۵. ۲ ^۳ ۰; (۵. 87
	0.65° 0.71°; (0.85)° 0.45° 0.7°; (0.87)° (0.72)°; (0.86)°; (0.787)
LIF	0.82 ^b
CaBr	0.82 ⁶ 0.38 ^a

Biles, R.T. and Heer, C.V., Phys. Rev. 105, 914 (1958).
Silbes, R.T. and Heer, C.V., Phys. Chem. Solide 7, 14 (1958).
Silbes, R.H. Phys. Rev. 103, 1675 (1956).
Pkk, ME., Ann. Physik, 31, 2655 (1958).

Doyle, W. T. Phys. Rev. 111, 1071, (1988).

CAPITULO II.- TRABAJO EXPERIMENTAL

II.1- CRECIMIENTO DE CRISTALES NaCl Y KC1 CON IMPUREZAS MONOVALENTES.

Las muestras utilizadas para éste estudio, en general, fueron crecidas en nuestro Laboratorio del Departamento de Fisica Molecular de la Universidad Autónoma Hetropolitana (Iztapalapa). Para un crecimiento cristalino a partir del punto de fusión, existen varias técnicas pero las más comunes son la de Bridgman-Stockbarger y la de Kyropoulos. Para la realización de éste trabajo, se procedió conforme al primero que consiste en tener el fundente contenido en un crisol. Este crisol, de fondo cónico se va bajando tentamente a través de un fuerte gradiente de temperatura que se mantiene en una junta de un horno de doble zona. Primero se forma un núcleo cristalino en el extremo cónico y continúa el crecimiento en la medida que el crisol se va bajando, hasta que se solidifica el fundente total. Ver Figura 16.

En nuestro esquema hubo algunas variantes que son las siguientes: La cápsula junto con su contenido de la mezcla sal + impurezas se introduce en una horno, en el cual se eleva la temperatura hasta el punto de fusión de la sal en cuestion; en el caso del NaCl o del KCl son 801°C y 770°C respectivamente. Se cierra bien el horno y se comiensa a disminuir lentamente la temperatura a una velocidad de 10°C cada 30 minútos en lugar de ir bajando el crisol a través del gradiente de temperatura. Dentro de el horno hay un gradiente entre la parte interior que es donde se tiene el elemento calefactor y la parte exterior que es en donde se tiene la puerta de acceso (lo cual se usa como el gradiente de temperatura para dar lugar al crecimiento cristalino). En realidad se tienen otros gradientes de temperatura los cuales en cierta madida influyen en el proceso de crecimiento; además de que también influye la velocidad con la que se disminuve la temperatura. Sin embargo, las muestras obtenidas presentaron una buena estructura monocristalina, lo cual permitió cortar bién (sobre los planos de clivaje), pequeñas piesas cristalinas cuyas dimensiones aproximadas fueron de 5x5 [mm] de area y de 1 a 2 [mm] de espesor.

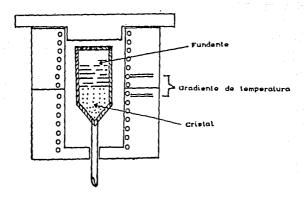


FIG. 16 -EEQUEMA DEL HORNO DE GREGIMIENTO POR EL METODO BRIDGMAN.

La concentración de impurezas monovalentes de los cristales dopados se da en la Tabla III; indicando el tipo de impureza dopante. La medida de esta concentración fué determinada por metodos analíticos de emisión de flama en el Instituto de Física de la UNAM, por la M. en C. Cristina Garza.

w Los cristales de NaCl fueron crecidos con polvos de NaCl de los Laboratorios J.T. Baker. Estos traen un contenido de Potasio (K) de 0.008%, que es equivalente a 8 ρ, ρ, m , entre otras impurezas.

** En forma analoga los cristales de KCl fueron crecidos con polvos de los Laboratorios Herck. Estos traen un contenido de sodio (Na) de 0.02%, que es equivalente a 200 p.p.m., entre otras impurezas.

WWW Este cristal fué crecido en el Instituto de Fisica,
UNAM. por R. Guerrero y su pureza es menor de una parte por
millón.

TABLA III

CRISTAL	CONTENIDO DE IHPUREZAS®	TIPO DE IMPUREZAS	
(ρ. ρ. m.)			
NaCl	1825	κ*	
NaCl	696	κ*	
NaCl	107	K *	
NaCl	76	κ *	
NaCl	62 "PURO" ×	K *	

CRISTAL	CONTENIDO DE IMPUREZAS.		TIPO DE IHPUREZAS		
(ρ. ρ. m.)					
KCI	385		Na [◆]		
KCl	180		Na ⁺		
KCl	147		Na [†]		
KCl	24		Na ⁺		
KCl	38	"PURO" ##	Na*		
KCI	"ULTRA-PURO" ###		Na+		
NaCl	271		Li ⁺		
NaCl	256		Lt*		
NaCl	153		Li*		
NaCl	54		Lt*		
NaCl	14		Li ⁺		

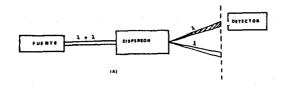
II.2 TECNICAS DE MEDICION. ABSORCION OPTICA Y ABSORCION ATOMICA.

Actualmente hay disponibles una gran variedud de técnicas espectroscópicas para la realización de los estudios de las propiedades de los centros de color. Obviamente, estas dependen del estudio que se trate y del interés del investigador. Para los propósitos de este trabajo describimos aqui las técnicas de Absorción Atómica y Absorción Óptica. En la sección posterior se mostrará el proceso de la irradiación por rayos-X de las muestras cristalinas^{2,4}.

La Espectroscopia de Absorción Óptica y de Absorción Atómica (emisión de flama) se utilizan para identificar los átomos y las moléculas de la muestra en estudio por medio del análisis de la radiación emitida o absorbida por ellos. En la Fig. 17 se muestra esquemáticamente los elementos necesarios de un sistema espectroscópico para (a) la emisión y (b) para la absorción. En la emisión la fuente presenta alguna forma de arco, un resplandor de descarga, una descarga impulsiva, etc., en el cual el átomo bajo estudio es exitado, generalmente, por

colisiones electrónicas. En la absorción la fuente base debe tener más o menos un espectro continuo sobre el rango de la longitud de onda relevante, en este caso entre 190 y 900 mu seguido por una celda de absorción. El dispersor o analizador, funciona separando de la luz emitida la longitud de onda que corresponde a la fuente. Finalmente el detector, es la placa fotográfica o el detector fotoeléctrico o algún otro aparato que registre la intensidad incidente como función de la posición.

En general la absorción atómica hace uso de la flama principalmente en el estudio de las moléculas y radicales formados en el proceso de combustión, en espectroscopia de absorción atómica y en el análisis espectroquímico. Aquí, la técnica de emisión de flama la utilizamos para verificar las concentraciones de impurezas monovalentes en nuestros cristales.



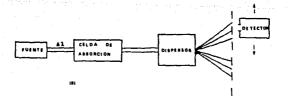
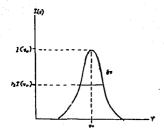


FIG. 17. - ESQUEMA DEL SISTEMA ESPECTROSCOPICO PARA

(A) LA EMISION Y (B) LA ABBORCION.

Al analizar la longitud de onda de la luz de una descarga gaseosa se encuentra que el espectro producido consiste de líneas discretas, bandas o quizis en el extremo un continuo. Cada linea o banda es característica de un Atomo o banda particular, y una vez que la linea característica patrón se conoce, su aspecto en el espectro establece la presencia de ese itomo en la fuente. Teóricamente los anchos de espectrales se discuten involucrando únicamente instrumentales, esto es. la forma en la cual un aparato dispersor propaga hacia afuera una linea monocromática ideal. Pero dicha linea, en realidad no existe. Cualquier transición atómica o molecular es asociada con una propagación de energia finita y por lo tanto a una frecuencia. Ahora debemos transferir el comportamiento ideal de las fuente espectrógrafo y considerar la forma de la linea producida por una fuente de luz real y un espectrógrafo de poder de resolución infinito.



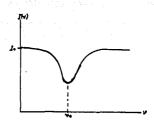


FIG. 18. A. -PERFIL DE LA LINEA DE EMISION.

FIG. 18, B. -PERFIL DE LA LINEA DE ABSORCION.

Las formas de la linea se pueden estudiar experimentalmente ya sea en la emisión o en la absorción. En cada caso, debemos suponer que barremos la linea con un espectrómetro de ancho instrumental despreciable, dando una señal de salida lo proporcional a la intensidad incidente. Entonces una linea de emisión de frecuencia central vo, tendrá una forma como la mostrada en la Fig.18. A Similarmente, una linea de absorción vista por una base continua, de intensidad lo, aparecerá como en la Fig.18. B.

La forma de estas curvas están determinadas por la dependencia de la frecuencia, de los coeficientes de absorción

y emisión del gas de la fuente, $k_{\rm p}$ y $j_{\rm p}$ respectivamente; además también son afectadas por la absorción y la re-emisión de la radiación producida por la profundidad de las capas que estén en su trayectoria, del ancho y vibraciones de la red. En esta parte se tiene interés únicamente con los perfiles de linea intrinsecos representados por k y j. Para la linea de emisión, esto significa que toda la radiación emitida es alcanzada por el espetrómetro sin re-absorción; esto es, la fuente (la muestra) es "ópticamente delgada". Y entonces $l_{\rm p}$ es simplemente proporcional a la emisividad $j_{\rm p}$ y la figura 18.% se puede observar como una gráfica de $j_{\rm p}$. Para la linea de absorción, $k_{\rm p}$ de la Fig. 19.50 obtiene de la siguiente forma.

Cuando la luz pasa a través de un medio absorbedor, la energia absorbida en una distancia Ax es proporcional tanto a Ax como al flujo incidente. La constante de proporcionalidad en general, viene siendo una función de la frecuencia. La ecuación:

$$-\Delta I_{\nu}(x) = k_{\nu} I_{\nu}(x) \Delta x$$
(14)

define al coeficiente de absorción k_y , expresado usualmente en $Icm^{-1}J$ o $Im^{-1}J$. Para un espesor l del medio absorbente, la relación entre la intensidad incidente y la emergente se

encuentra por integración de la ecua yación (14) dando:

$$I_{\nu}^{(1)} = I_{\nu}^{(0)} e^{-J_{0}k_{\nu}dx} \longrightarrow ...(15)$$

doncte $\int_0^1 k_y dx$ es la profundidad \Leftrightarrow óptica del medio. Si este es homogéneo, de tal manera que k_y , es inclependiente de x, la profundidad óptica es k_y l y así lens—nemos:

$$I_{\nu}(1) = I_{\nu}(0)e^{-k}\nu^{1}$$
(15)

La absorción de una linea especircaral als Lada es propagada sobre un rango de frecuencia finita por arios di ferentes mecanismos de ensanchamiento, y una gráfica de El $I_{\nu}(1)$ contra ν tiene la forma general de la Fig.12. Esta granzifica proporciona el dato experimental a partir del cual se esce oblienze por la ec. (15), el valor de k_{ν} :

$$k_{\nu} = \frac{1}{1} \ln \frac{II}{II} = \frac{I(0)}{I_{\nu}(1)}$$

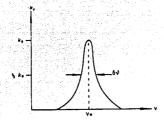


FIG. 19. -CONFIGIENTE DE ABRORGION COMO FUNCION DE LA FREQUENCIA.

La Fig.19 muestra una gráfica típica de k_{ν} contra ν . Es importante hacer notar que a pesar de las apartencias la Fig.19 no es exactamente la Fig.18.b invertida, a menos que k_{ν} l « 1 de tal manera que la ec. (15) se puede escribir como:

$$I_{\nu}^{(1)} = I(0)(1 - K_{\nu}^{(1)})$$

En este caso la inclinación hacia abajo $I(o)-I_{\nu}(l)$ es realmente proporcional a k_{ν} . Dado que, si los términos de orden $k_{\nu}^2 l^2$ no se pueden despreciar en la expanción de la exponencial, las dos curvas difieren en la forma y en el tamaño.

Algunas veces la absorción es expresada en términos del coeficiente de absorción atómica, usualmente escrito como a_{ν} . Este esta relacionado a k_{ν} por $a_{\nu}=k_{\nu}/N$, Donde N=# de centros absorbidos/cm⁻⁸. Así que la ec. (15) resulta:

$$I(1) = I(0) \bullet^{\alpha l} \qquad (15)$$

Así en la medición de la absorción óptica, la absorción de un cristal que contiene centros de color es comparado con un cristal que no contiene centros de color. Esta comparación se hace como función de la longitud de onda de la luz utilizada. Si lo es la intensidad de luz transmitida por el cristal no coloreado e I la intensidad de luz transmitida por el cristal coloreado, la absorción se puede describir por la densidad óptica (O.D.) la cual se define como:

esta definición supone que la luz incidente es de intensidad constante. De estas dos últimas ecuaciones se obtiene a como se procedió en la sección I-4 la cual resulto:

$$\alpha = 2.303 \left[\frac{0.D.}{X} \right] \dots (172)$$

Para obtener los espectros de absorción de nuestros cristales en estudio se utilizó un espectrofotómetro de doble

haz Perkin Elmer, Hodelo Lambda 5 UV visible. En la Fig 20 se muestra el diagrama del sistema óptico. Este aparato está equipado con dos lámparas, una de tungsteno-halógeno y otra de Deuterio, lo cual permite determinar el espectro de absorción, en el intervalo de 190 a 900 nm, de sólidos cristalinos. Este equipo cuenta con un juego de filtros (FW) montados sobre un soporte circular (controlado por medio de un motor de pasos) y de un brazo en el que se encuentra fijo un espejo 100% reflejante M₂ y en el que también se ha practicado una perforación. De ésta manera, al moverse en forma sincronizada el sistema de filtros y el brazo, se puede seleccionar la longitud de onda de la luz que finalmente incide sobre la muestra que se esta estudiando.

Asi, cuando el brazo se encuentra bajo la radiación que proviene de la limpara de deuterio (DL) es bloqueada, mientras que la que proviene de la limpara de Halógeno (HL) es reflejada en el espejo H₂ (colocado en el brazo) en dirección de otro espejo 100% reflejante H₁ y finalmente (pasando por el orificio en este braso) incide sobre alguno de los filtros colocados en FW. Cuando el brazo H₂ se levanta, la radiación de la limpara de Deuterio DL incide sobre el espejo H₁, de donde es reflejada para incidir finalmente sobre alguno de los filtros de FW después de pasar a través del orificio del brazo.

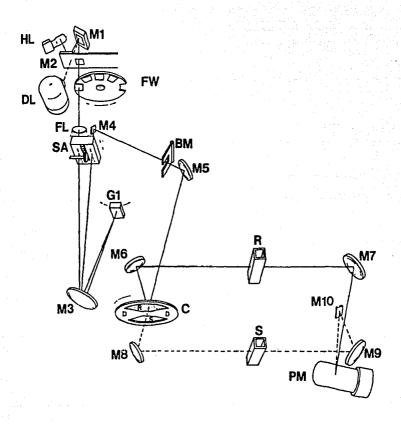


FIG. 20 -DIAGRAMA DEL SISTEMA OPTICO DEL ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION PERKIN-HELMER λ -5

79

ESTA TESIS MA PARE SALIR DE LA MALAJECA Después de que la radiación seleccionada (de la limpara HL 6 DL, respectivamente) pasa a través de alguno de los filtros de FW, es enfocada por medio de la lente FL para que pase a través de las ventanas SA. Entonces es colimada y reflejada por el espejo H₂ para que incida sobre la rejilla de reflexión G1. Aquí se produce la dispersión del has de lus y, con esto, la formación de un espectro.

La posición de la refilla de reflexión permite seleccionar la parte del espectro que se refleja nuevamente sobre H. para pasar nuevamente a través de una de las ventanas en SA. Con esto, se elije (finalmente) un haz de luz monocromático. El haz monocromático pasa enlonces a través de SA y se refleja en M, y $H_{\rm m}$ respectivamente. El haz incide sobre un disco C sobre el que se ha hecho un orificio 5 y se ha colocado un espejo 100% reflejante R. Cuando el disco C esta en una posición tal que el haz que proviene de H incide sobre su superficie R, éste es reflejado hacia el espejo H con lo que se obtiene un haz de referencia. Por otra parte, cuando el haz de H_m incide sobre el disco C cuando éste se encuentra en una posición tal que permite su paso a través del orificio S, el haz incide sobre el espejo M_e para que se obtenga el haz de la muestra. Los haces (de referencia y de la muestra) pasan a través de las rejillas de referencia y de la muestra respectivamente, y son relfejados por los espejos H, y M, respectivamente. De esta forma el haz

de referencia es reflejado directamente sobre el elemento detector del equipo (un tubo fotomultiplicador) mientras que el haz de muestreo es reflejado primero por el espejo M₁₀ para después incidir sobre el fotomultiplicador PM.

Cabe señalar que el camino óptico recorrido por los dos haces resulta ser el mismo en el equipo λ -5, con lo que se garantiza la optima detección de los espectros de absorción. La señal detectada por el folomultiplicador, es procesada en el λ -5 por medio de una microcomputadora incorporada al sistema, y la información que se obtiene en este tipo de experimentos, corresponde al valor de la densidad óptica (O.D.) de la muestra como función de la lonfitud de onda de la lus incidente.

Como se mencionó en ol primer capítulo los cristales iónicos de los halogenuros alcalinos son transparentes en la región visible del espectro electromagnético en su estado puro (sin imperfecciones) y únicamente para el rango infrarojo se tiene absorción. Esta absorción es debida a la vibración de iones que están sujetos a una onda electromagnética excitadora, lo cual ocurre a una frecuencia de 10¹³cps. Así, en general, las sales puras tienden a ser completamente transparentes en la región visible del espectro. Sin embargo las sales impuras, en general pueden presentar coloración, dado que la energía es

absorbida por las impurezas u otras imperfecciones puntuales, en ciertas regiones (llamadas bandas de absorción) del espectro visible. En los halogenuros alcalinos se tiene una gran variedad de bandas de absorción. Aqui consideramos las bandas de absorción generadas por los centros "F". Estos a su vez son generados por la captura de electrones en las vacancias iónicas negativas, durante la irradiación del cristal. manifiesta fisicamente con un color caracteristico que depende del cristal en consideración; esto es, un cristal de NaCl adquiere un color amarillo-café y un cristal de KCl toma un color azúl. Este color se debe principalmente a la banda de absorción "F" cuya longitud de onda característica en el espectro de absorción es de 455 nm para el NaCl y de 556 nm para el KCl, las cuales caen en la región visible del espectro. En la figura 6 podemos ver las bandas de absorción del KCl puro para diferentes dósis de irradiación.

II. 3. -IRRADIACION DE LOS CRISTALES.

El término radiación ionizante incluye todas las fuentes que pueden generar electrones libres y huecos en un material. El rango de energias cubre desde los fotones ultravioleta de alrededor de 10 eV, por medio de rayos-X ligeros de 10-60 KeV y Rayos Gama Co(60) de 1.25 MeV, hasta arriba de los fotones de alta energia de 100 MeV. Cada una de estas fuentes tiene sus propias dificultades experimentales. Las fuentes de fotones ultravioleta son débiles en intensidad y es dificil obtener energias monocromáticas. Los rayos-X ligeros tienen un amplio espectro de energia y dado que el coeficiente de absorción para fotones de estas energias es fuertemente dependiente de la energia, la coloración siempre es muy intensa en la superficie y tiene una dependencia exponencial lejos de la superficie.

La coloración, en general se produce cuando un cristal de un halogenuro alcalino se expone a radiación comprendida en la región excitónica. En los cristales iónicos tiene lugar una cierta absorción de luz incidente para fotones con energía ligeramente inferior a la necesaria para excitar electrones completamente a través del intervalo de energía, Fig.21 y Fig. 22. Esta absorción se manifiesta en un "pico excitónico" para

Figuro 21. - Estructura de banda, sequemática, de un cristal fónico unornala. Los máximos y mínimos de las bandas se encuentran en k = 0; puede habor absorción luminosa en una transición vertical: —, por ejemplo, excitación directa de electronas y huecos a k = 0. Se ha utilizado la notación normal, representando [100] a la derecha y (111) a la irquierda.

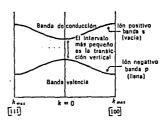
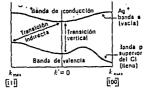


Figura 22. En el AgCl, el máximo de la banda de valencia tiene lugar en k_{pla} en [111], conduciendo, entunces as una absorción luminosa indirecta.



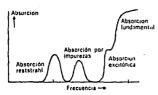


Figura 23 - Absorción de radiación electromagnética por cristales iónicos en función de la frecuencia.

energias ligeramente inferiores a las correspondientes al borde de la absorción Fig. 23. La característica del pico excitónico que lo hace diferente de la absorción fundamental es que el cristal no muestra conductividad eléctrica extra cuando la luz excitónica está siendo absorbida. Este hecho experimental se explica, suponiendo que la absoción excitónica produce pares de electrones y huecos enlazados. Como los electrones y los huecos tienen cargas opuestas, se atraen mutuamente, produciendo niveles de estados enlazados similares a los del Atomo de hidrógeno. Si los estados enlazados tienen energias menores que la del par electrón-hueco separado (ionizado, por ejemplo), los niveles de energia excitónica están situados en el intervalo de la banda prohibida; estando por debajo del limite de la absorción fundamental en una cantidad aproximadamente igual a los níveles de los estados hidrogenoideos en el continuo dieléctrico. Si el electrón y el hoyo (o hueco) están enlazados entre si el par es una entidad neutra y no contribuye a la conductividad eléctrica1,22.

Por lo anterior se pueden distinguir tres diferencias en la radiación ionizante que produce a los centros F. La primera llamada radiación por excitones, es aquella en la que la energía de la particula de bombardeo (fotón o electrón) es suficiente para crear un par electrón-hueco, pero sin disociarlo completamente. Dicho par se mantiene unido por su

atracción Coulombina y viajan así a través de la red. Uno puede imaginar al excitón como si fuera un átomo metálico acoplado a un átomo halogenuro. Esta estructura no es estacionaria, ya que el electrón extra en el ión metálico puede brincar de ión a ión, seguido por el hoyo. Este par puede reaccionar con otras imperfecciones de la red, y el electrón (o hueco) puede ser capturado y alcanzado por el hueco (o el electrón). Cabe mencionar, que no existe una manera simple de separar completamente la creación de excitones de la excitación de iones impureza embebidos en el cristal. En la actualidad parte de la absorción que se cree debida a exitones, puede ser causada por exitación de iones impureza.

Una segunda diferencia se establece con la llamada "radiación fuerie". Si uno observa el cristal como una colección de iones aislados, se requiere la conservación de energia y momento en la interacción entre un tón y una particula rápida. Las masas de los rayos-X o electrones son tan pequeñas que pueden transferir unicamente una pequeña fracción de su energia a los iones pesados. Por ejemplo, la energia que un fotón debe tener para impartir los 25 eV que necesita un tón de Cl₂ para moverlo de su sitio, es de 645 KeV; y 400 Kev si se trata de un electrón. Esta es aproximadamente la radiación (energia) requerida que puede causar desplazamientos iónicos directos fuera de los sitios de la red; la cual es muy alta. Y

es por esta razón que se le llama "radiación fuerte".desplazamiento iónico directó para lo cual se requirió de uma "radiación fuerte". Por último la "radiación suave" es aquella que imparte menos de los 25 eV; mientras que la radiación fuerte es la que puede causar desplazamientos iónicos directos fuera de los sitios de la red²⁶.

Un último tipo de radiación es la llamada "radiación suave" y es aquella que imparte menos de los 25 eV.

Siguiendo con la evolución del presente trabajo, una vez que fueron crecidas las muestras cristalinas se llevó a cabo el proceso de la irradiación para lo cual fué utilizado un Generador de Rayos-X, Philips, Modelo PW 1140/00/60 de tubo de cobre. La muestra cristalina (de 5 x 5 x 0.25 mm²) fué sometida primero a un tratamiento térmico a 400 °C durante 20 o 30 minulos. Inmediatamente despues se colocó sobre un bloque de cobre a temperatura ambiente. Una vez hecho ésto, la muestra se colocó sobre un portamuestras dentro de una cimara de cobre Chindada con plomo) para exponerlo a los rayos-X. Estos fueron filtrados con un filtro de aluminto de 1 mm de espesor para el endurecimiento del haz, es decir para eliminar los rayos de menor potencia logrando con ello una coloración uniforme del cristal. Además, se tomó la precaución de evitar el

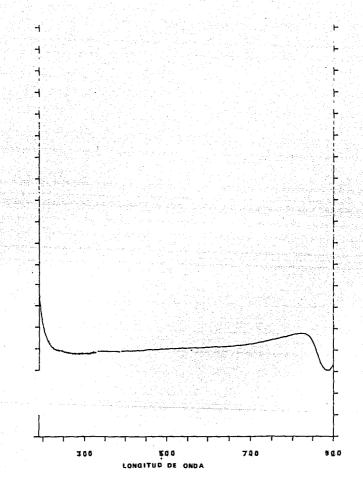


FIG.24.- ESPECTRO DE ABSORCION FUNDAMENTAL PARA LA MUESTRA CRISTALINA DE KCLINA (24 p.p.m.), SIN IRRADIAR.

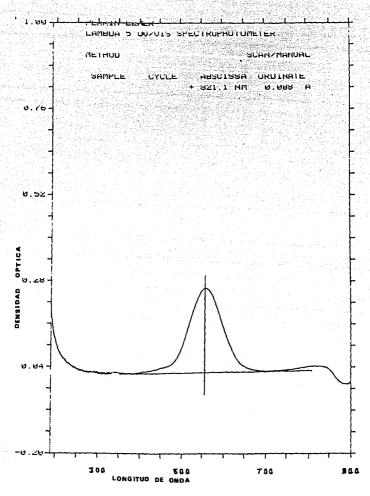


FIG. 25. - ESPECTRO DE ABSORCION DEL KCLINA C24 p.p.m.).
CON 20 HIMUTOS DE IRRADIACION.
89

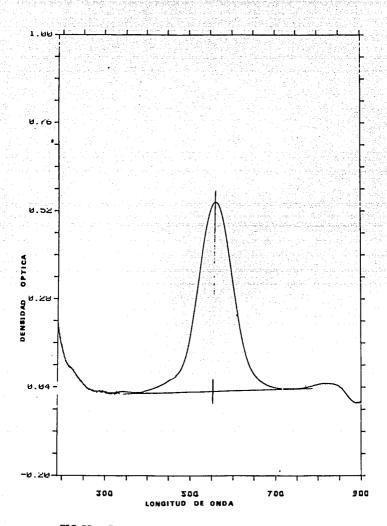


FIG. 25. - ESPECTRO DE ABSORCION DEL KC1: N_B^+ (24 p.p.m.). CON 60 MINUTOS DE IRRADIACION.

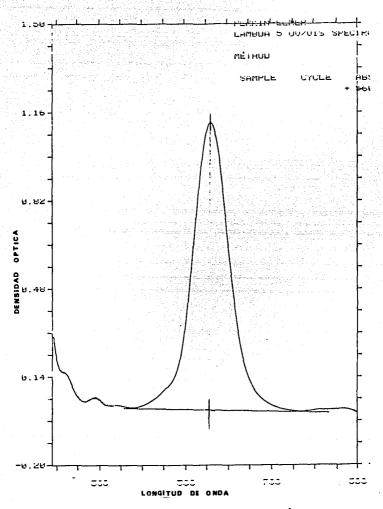


FIG. 27. - ESPECTRO DE ABSORCION DEL KCI:Na (24 p.p.m.).
CON 140 NINUTOS DE IRRADIACION.

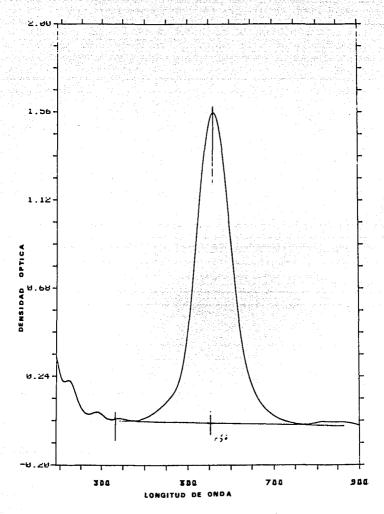


FIG.28. - ESPECTRO DE ABSORCION DEL KCI: Na^{+} (24 p.p.m.). CON 300 MINUTOS DE IRRADIACION.

sobrecalentamiento del cristal durante la irradiación ya que éste efecto puede confundir el origen de los resultados obtenidos.

En intervalos de 20, 60, 180 y 340 minutos (dósis de trradiación) se sacó el cristal de la cámara de trradiación para obtener su correspondiente espectro de absorción (ver fig. 25, 26, 27, y 28); tomando la precaución en que el tiempo de trradiación suspendida fuera lo más corto posible para perder la menor información posible.

Una vez que se tiene el espectro de absorción, se mide la altura de la banda F a partir de una linea base horizontal como se muestra en la figura 25. Con ello se elimina la absorción característica del cristal (Fig.24) que, como se mencionó anteriormente, corresponde a la absorción de la banda fundamental. La altura h multiplicada por el factor de escala elegido en el espectrofotómetro nos da el vulor de la densidad optica C. E. mencionado en la secución unterior. El mismo procedimiento se sigue para cada dosis y para cada cristal respectivamente.

CAPITULO III.-RESULTADOS Y DISCUSION

III.1 CURVAS DE COLORACION

Para la presentación de los resultados obtenidos hemos clasificado las muestras cristalinas por sistemas. El sistema NaCl:Li⁺ son los cristales de NaCl dopados con impurezas de Li⁺ y los sistemas de NaCl:K⁺ y KCl:Na⁺ son aquellos cristales de NaCl y KCl dopados con impurezas de K⁺ y Na⁺, respectivamente. Las concentraciones de las impurezas (metalico-alcalinas) de cada sistema fueron dadas en el capítulo anterior y aparecen en las gráficas de coloración correspondiente. Las concentraciones más bajas corresponden a la muestra cristalina crecida sin agregarle nungún tipo de impureza.

Como se describió en el capitulo anterior, tomando la medida de la densidad óptica O.D. del espectro de absorción, se determina el valor del coeficiente de absorción $\alpha_{\rm p}$, sustituyendo en la ecuación (17). Este es una medida de la

concentración de centros F, ya que está relacionado con el número de dichos centros a través de la ecuación de Smákula (13); este cálculo no se realiza aqui, dado que no se tiene una información exacta de la constante del oscilador para los sistemas cristalinos estudiados. Así, obteniendo a para cada dósis de irradiación se obtienen los datos para la gráfica a contra el tiempo de irradiación, que viene siendo la curva de coloración de una muestra. El mismo proceso se realiza para cada muestra cristalina.

Los resultados obtenidos para el sistema KCl:Na* son mostrados en la figura 29. Los experimentos para la coloración de estos cristales fueron realizados cuatro veces reproduciendo las mismas curvas de coloración; por lo que la a graficada corresponde al promedio de dichas mediciones, en cada dósis respectivamente. Estos resultados muestran claramente, que existe una dependencia de la coloración con la concentración de impurezas de Na; más aún, a mayor concentración de impurezas se tiene mayor coloración. Se manifiesta también un cambio en las curvas de coloración F en relación con la pureza del cristal Cuer las curvas marcadas con "A" y con "x" correspondentes a zero de coloración.

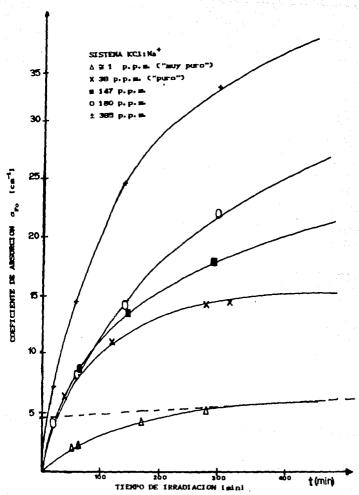
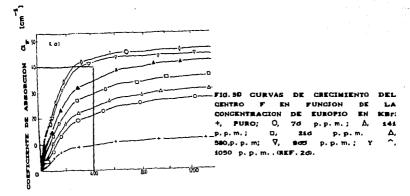


FIG.29. - GRAFICA DE LAS CURVAS DE COLORACION F PARA EL SISTEMA KCLINA, PARA DIFERENTES CONCENTRACIONES DE Ma $^{\circ}$.

ilomos de K⁺ (curvas de coloración señaladas con . 147 p.p.m.; 0, 180 p.p.m.; y sobretodo la curva de t. 385 p.p.m.) la curvas de coloración tienen un comportamiento similar al de la fig. 10a Cen el Modelo de Aguilar), lo cual sugiere que el tipo de trampas de los intersticiales que se tiene en este sistema, son térmicamente muy estables a=0; y además indica que los intersticiales halógenos están siendo atrapados en las vecinadaes de las impurezas monovalentes de Na⁺.

Considerando que estamos introduciendo un atomo impureza (Na[†]) de menor iamaño que el atomo alcalino (K[†]) de la red, se puede hacer una comparación de nuestros resultados con aquellos obtenidos en los halogenuros alcalinos contaminados con impurezas divalentes en donde el atomo impureza (por ejemplo Eu^{2†} en KBr. Fig. 30) también es de menor tamaño que el atomo alcalino de la red pero con una carga "extra" con respecto a la red. Como puede observarse de la figura la coloración en KBr: Eu^{2†} es mayor que la que obtenemos en KCl: Na[†], desde luego para condiciones experimentales semejantes. De acuerdo con ésto, se infiere que el efecto de la carga neta asociada con los dipolos I-V formados por las impurezas divalentes y las vacantes de catión asociados, tiene una relevancia mayor en el

proceso de atrapamiento de los intersticiales que el ejecto del campo de deformación creado por la impureza.



Por otra parte, si graficamos en escala logaritmica la cantidad de coloración de la primera etapa (apo) como función de la concentración de Na⁺ (Fig. 32) encontramos una buena correspondencia líneal. Los valores de apo se obtuvieron por extrapolación de la parte lineal de cada una de las curvas de crecimiento de los centros F, hasta alcanzar la ordenada al origen, (vease la linea recta sobre la curva correspondiente a \cong 1 p. p.m. de Na⁺, en la fig. 29). Al realizar el ajuste por minimos cuadrados obtenemos un valor para la pendiente de 0.35 \pm 0.13. Esto expresa que para el sistema KCl:Na⁺ el peso de la primera etapa de la coloración es relativamente proporcional a

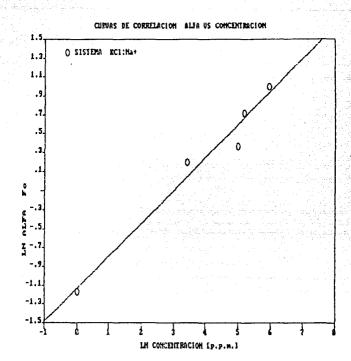


FIG. 32. – GRAFICA DE CORRELACION EN ESCALA LOGARITHICA DE $x_{\rm Fo}$ y la concentracion (en p. p. m.) de impurezas monovalentes para el sistema KClina $^+$.

la raiz cuadrada de la concentración de impurezas de Na^{\dagger} ; lo cual manifiesta un comportamiento semejante al encontrado para los halogenuros alcalinos dopados con impurezas catiónicas divalentes, en donde el peso de la primera etapa es proporcional a la raiz cuadrada de la concentración de impurezas (L. a $\alpha_{n0} = k E^{1/2}$).

En la fig. 33 se muestran los resultados obtenidos para el sistema NaCl:K⁺. Nuevamente se manifiesta un comportamiento similar al de la curva teórica de la fig 10(a) (Modelo de Aguilar, donde a=0), por lo que en este caso se infiere también que existen centros intersticiales o trampas de halógenos estables. Como puede observarse las curvas de coloración para diferentes concentraciones de impurezas se traslapan; lo cual muestra una independencia de la coloración F. con concentración de los iones de potasio K*. Esto expresa que la deformación de la red producida por la sustitución del átomo de Na por el átomo de potasio K, no influye significativamente en la producción de centros F; además si comparámos ésto con los resultados obtenidos en los halogenuros alcalinos contaminados con impurezas divalentes, en donde se tienen impurezas divalentes cuyo radio iónico es mayor que el radio iónico del atomo alcalino de la red (por ejemplo, Eu²⁺ en NaCl

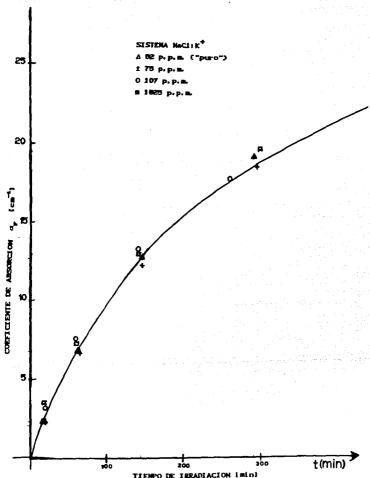


FIG. 33. - GRAFICA DE LAS CURVAS DE COLORACION F PARA EL SISTEMA NaClik[†], PARA DIFERENTES CONCENTRACIONES DE K[†].

fig. 34²⁷; vemos que si hay una variación en la coloración que se sabe bién, es debida al atrapamiento de los intersticiales por el(los) dipolo(s) I-V. Esto conduce a concluir que la coloración es favorecida más por la carga de la vacancia que por el campo de esfuerzos creado por la sustitución de la impureza.

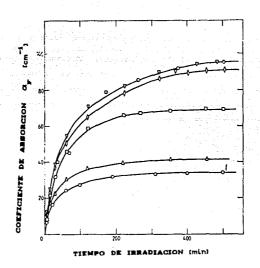


FIG. 84. - CURVAS DE CRECIMIENTO DEL CENTRO F EN FUNCION DE LA CONCENTRACION DE EU² EN NaCliO, 2P p. p. m.; Δ.58 p. p. m.; □,448 p. p. m.; Λ. 257 p. p. m.; Υ. 200 p. p. m.; Θ, 4400 p. p. m. (REF. 27).

Las curvas de coloración-F obtenidas en los cristales del sistema $\operatorname{NaCl:Li}^+$ (Fig. 35) presentan un comportamiento no esperado, dado que en este caso resulta que la coloración disminuye en forma monótona a medida que la concentración de Li^+ aumenta. Giuliani²⁸ hace un análisis de las propiedades del crecimiento y del decaimiento térmico de las bandas I y V_i , con respecto a las bandas a y F para la producción de centros F en KBr conteniendo impurezas alcalinas de Li , Na y Rb ; en el cual muestra que el aumento de la producción del centro F y a es debido al atrapamiento y estabilidad de los halógenos intersticiales por las impurezas de sodio o litto, que son átomos más pequeños que el átomo de potasio. Sin embargo, el Rb que es un átomo más grande no afecta la producción del centro de color.

Por otra parte, Giuliani y coolaboradores^{2P}, muestran también que el número de intersticiales atrapados por las impurezas monovalentes está limitado por la difusión de las vacancias aniónicas y su recombinación con los intersticiales; como consecuencia de ello, las impurezas de litto introducen una "rápida" etapa de saturación en la curva de crecimiento del centro F. Sin embargo, no se tiene información acerca de si ésta "rápida" etapa de saturación aumenta o disminuye con la

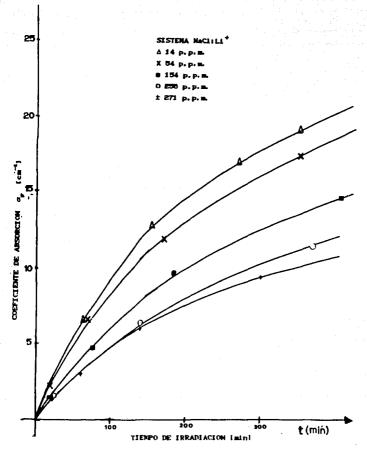


FIG. 35. - GRAFICA DE LAS CURVAS DE COLORACION F PARA EL SISTEMA NaCI:LI † , PARA DIFERENTES CONCENTRACIONES DE LI † .

concentración de Li^+ ; nuestros resultados muestran que ésta etapa disminuye de lo cual se concluye que el tipo de trampas que se tiene para éste sistema NaCl: Li^+ , son altamente ineficientes.

Una posible explicación a ésto es que el Li tiene una tendencia muy grande a agruparse formando aglomerados de dos o mis iones de Li⁺ que podrian estar atrapando a los intersticiales en forma muy ineficiente. En relación a esto Kondo y colaboradores han mostrado que para altas concentraciones de Agt, Cut, Tlt o Pbt se reduce dramaticamente la producción inicial de la coloración-F. Esto ha sido atribuido a la captura de los electrones por la impuresa, la cual cambia su estado de valencia a un estado de carga reducida y por lo tanto está inhibiendo la eficiencia de la recombinación del centro de color y el excitón auto-atrapado CSTE), el cual es producto de la relajación del par electron-hueco durante la trradiación esto daria otra explicación a este efecto. Sin embargo, la Agt. el Cut y el Pot son elementos metálicos que pueden cambiar su estado de valencia con mayor facilidad que el Lit, de hecho se sabe que el Lit y el Nat en KCl no muestran ese cambio¹⁸, por esto creemos que la primera interpretación es mas confiable.

III.2. - COMPARACION ENTRE RESULTADOS

En la sección anterior hemos presentado un análisis de nuestros resultados considerando los sistemas por separado y comparando cada uno de ellos con lo que se ha obtenido por otros autores, en los halogenuros alcalinos dopados con impuresas divalentes. La discusión que presentamos ahora es una comparación entre los resultados de dichos sistemas.

Dado que el interés de nuestro estudio es saber el comportamiento de las curvas de coloración, en ralación a la deformación o al campo de esfuersos creado por las impuresas monovalentes alcalinas (con diferentes radios ionicos en relación al tamaño iónico del ión alcalino de la red), es importante mencionar que éste efecto se puede observar prácticamente sobre la etapa I de la coloración-F, dado que, por un lado se tiene bién reconocido que ésta es fuertemente dependiente de las impurezas introducidas en el cristal. Por otro, se sabe que el atrapamiento de los iones intersticiales o átomos por iónes alcalinos ajenos cuyo radio iónico es más pequeño que el del ión alcalino de la red es un efecto que ha

sido ampliamente estudiado por absorción óptica y EPR (para átomos); dichos estudios ^{81,82,88} al ser comparados con impurezas divalentes han llevado a concluir que los intersticiales también son atrapados por impurezas monovalentes.

Podemos observar, de los resultados presentados en la sección anterior que la introducción de impurezas monovalentes en los halogenuros alcalinos manifiesta comportamientos diferentes en los tres sistemas estudiados aqui. Sin embargo, estos resultados muestran que la deformación de la red, con la cual se crea un campo de esfuerzos no interviene en forma importante en el proceso de la producción de centros F, tiene mayor efecto la carga de la impureza divalente. Veamos, la coloración producida para los cristales de NaCl contaminados con K' no manifiestó influencia alguna respecto a la concentración de impurezas de K⁺. Esto es, la mayoria de los puntos experimentales caen dentro de la misma curva. independientemente de la concentración de K*; de hecho dicha curva de coloración corresponde a la a obtenida en un cristal "puro" (señalado con 62.54 (p.p.m.)) al cual no se le agregó ningún tipo de impureza. Comparado con los otros sistemas el NaCl:Li⁺ y el KCl:Na⁺, en los que la coloración si cambia podemos concluir que si introducimos un alomo alcalino (K^{\dagger}) mayor que el alomo alcalino de la red, la coloración no se afecta.

En cambio con el NaCl dopado con li obtenemos cambios inesperados; esto es, la concentración de centros F va disminuyendo en la medida que va aumentando la concentración de li. Este es un resultado un poco extraño dado que se esperaba un comportamiento semejante al del sistema KCl:Na, puesto que en ambos sistemas se esta introduciendo en la red un ktomo alcalino más pequeño que el ktomo alcalino de la red. La causa de ésto no se ha podido esclarecer perfectamente, pero lo que si se puede decir es que la producción de centros F se ve afectada por la presencia del li dentro de la red, debido quizas a su tendencia a formar aglomerados y éstos a su vés funcionar como trampas inefectivas para los intersticiales.

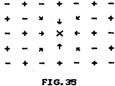
Por último, en el sistema ECL:No⁺ se observa un comportante no semejante al obtenido en los halogenaros alialinos dopados con impureza divalentes. Para este mismo sistema se tiene también que el grado de pureza del KCl afecta notablemente a la coloración como se puede ver en la fig.29.

las curvas correspondí entes a 38.04 p.p.m. de Na⁺ ("puro" este es el cristal crecido con los polvos comerciales») y el ultra puro menor a 1 p.p. zn. de Na⁺. Características que no se presentan en ninguno des los dos sistemas anteriores.

Resumiendo, de Zos tres sistemas estudiacios aqui, el sistema KCl:Na⁺ fué el que presentó en general, una mayor eficiencia para la proclucción de los centros F; mientras que en el sistema NaCl:K⁺ la introducción de diferentes concentraciones de impuresas de polasio, no presenta mayor relevancia. Sin embargo, el caso del NaCl:Li⁺ mauestra que la eficiencia de producción de los centros F disminuye.

III.3.-DISTORSION DE LA RED DEBIDA A LA IMPUREZA MONOVALENTE Y SU RELACION CON LA COLORACION.

Se puede ver facilmente, que si en una red cristalina de tipo halogenuro alcalina se introducen atomos alcalinos más chicos o más grandes, éstos pueden entrar a la red en forma substitucional y como consecuencia de ello hay una deformación en la red correspondiente a ese "intercambio" atómico. En particular consideremos en forma esquemática los casos de Li⁺ en NaCl y de Na⁺ en KCl; en donde el radio tónico del Li⁺ (0.60) es menor respecto al átomo del Na⁺ (0.95) y mucho menor respecto al del Ci⁺ (1.81); de igual forma el átomo del Na⁺ (0.95) es menor en relación al átomo de K⁺ (1.33). En ambos casos el átomo impureza es menor que el átomo sustituido por lo que daria lugar a un desplazamiento tónico "hacia adentro" como el que se muestra en la fig. 35 (pensando en que los átomos son esferas duras y que tienden a reacomodarse al haber un cambio en su dimensión).



Un efecto contrario (desplazamiento "hacia afuera") manifestaria en el caso del K⁺ (1.33) sustituyendo al Na⁺ (0.95).Fig. 36.

Lo anterior es apoyado por el trabajo de B. Douglas¹⁵, quien ha realizado un cálculo teórico de los desplazamientos de las capas tónicas; además del cálculo de la energia de repulsión de traslape, así como el cambio en las energia total de la red debido al "intercambio" atómico (esto es, de la diferencia de energias antes y después del remplazamiento iónico). Douglas define las coordenadas cartesianas (en la tabla IV) de las capas iónicas después de remplazar el ión el cual es ubicado en el origen. R₀ es el parámetro de la red Cobtenido de sus mismos cálculos); para el NaCl es 2.791x10⁻⁸ cm y para el KCl es 3.113x10⁻⁸ cm. Dichas coordenadas estan en función de los parámetros de relajación los cuales se muestran en la tabla V.

No. de Capa	No. de tones	Coordenadas
0	1	0.0.0
1	6	1(1+a),0,0
2	12	1(1+6),1(1+6,0
3	8	1C1+c2,1C1+c2,1C1+c2
4	8	2C1+dD,0,0
5	24	201+07.101+77.0
6	24	2C1+g),1C1+h),1C1+h)
7	12	2(1+1),2(1+1),0
8	6	3(1+1).0.0
9	24	2.2.1
10	24	3.1.0

TABLA. IV. - IDENTIFICACION EN COORDENADAS CARTESIANAS DE LAS CAPAS IONICAS EN FUNCION DE LOS PARAMETROS DE RELAJACION.

TABLA. V

	TABLA. V	•	
PARAMETROS DE RELAJACION	NaCl:Li*	NaCl: K*	KCl: Na+
a	-0. 03252	+0.05525	-0. 0425đ
ь	-0.00746	+0.01242	-0.00758
c	+0.00118	-0.00246	+0. 00148
ď	-0.00225	+0.00005	-0.00568
•	-0.00179	+0.00384	-0. 00220
f	-O. 003d8	+0.00647	-0.00 94 0
8	-0.000d	+0.00094	-0, DOOSZ
'n	-0.00004	-0.00005	+0.0000P
is t	-0.00102	+0.00180	-0.00107
j	-0.00019	+0.00059	-0.00109

Con estos datos se puede observar que los parâmetros de relajación son más grandes en el caso del K^{*} que sustituye al Na dado que la disparidad en tamaño es muy grande entre el ión que remplaza y el ión remplazado; y en ese caso las magnitudes de los parámetros decaen rapidamente con el aumento de distancia a oartir del ión imouresa. Sustituvendo relajación parámetros lα tabla especi ficamente coordenadus las (desolazadas), en donde se puede claramente desplazamiento de éstas respecto al tamaño de introducida.

Para el Sistema NaCl:li

No. de Capa	No. de tones	Coordenadas
0	1	0, 0, 0
1	6	0. 96748, 0, 0
2	12	0.99254, 0.99254, 0
3	8	1.00113, 1.00113, 1.00113
4	в	1.9955, 0, 0
5	24	1.99642, 0,99637, 0
6	24	1.99874, 0.99996, 0.99996
7	12	1.99796, 1.99796, 0
8	6	2.99946, 0, 0
9	24	2,2,1
10	24	3.1.0

Para el Sistema KCl: Na

No. de Capa	No. de iones	Coordenadas
0	1	0,0,0
1	6	0.95744, 0, 0
2	12	0.99242, 0.99242, 0
3	8	1. 00143, 1.00143, 1.00143
4	6	1.98816, 0, 0
5	24	1.9956, 0.9966, 0
6	24	1.99936, 1.00009, 1.00009
7	12	1,99786, 1,99786, 0
8	6	2.99676, 0, 0
• 9	24	2.2.1
10	24	3,1,0

Para el Sistema NaCl:K⁺

No. de Capa	No. de tones	Coordenadas
0	1	0,0,0
1	6	1.05525, 0, 0
2	12	1.01242, 1.01241, 0
3	8	0.99754, 0.99754, 0.99754
4	6	2.0137, 0, 0
5	24	2.00672, 1.00647, 0
6	24	2.00188, 0.99995, 0.99995
7	12	2.0036, 2.0036, 0
. B	6	3.00177, 0, 0
9	24	2,2,1
10	24	3,1,0

Las nuevas coordenadas del campo de deformación "hacia afuera" creado por la impureza de K⁺ al estar ocupando un atomo de Nat; así como las energias Ctanto de repulsión como el cambio en la energia total, ver tabla VID, las cuales son positivas para el caso en el que el 1tomo impureza es de mayor tamaño que el átomo alcalino de la red al cual sustituye, nos muestran la imposibilidad de que se produzca un defecto más en ése sitio; esto es el intersticial no puede ser atrapado por la impureza monovalente debido, ya de por si, a que hay una energia de repulsión positiva. Como consecuencia de ello no puede haber más coloración aunque se aumente la cantidad de atomos de K⁺ dentro de la red. De hecho cuando se tiene un cristal "ouro" y se irradia, esta da lugar a los centros F y su correspondiente átomo halógeno intersticial H: intersticial es libre de moverse por toda la red a menos que sea atrapado por algún defecto (una impureza, por ejemplo) si éste defecto aumenta la coloración aumentaria también. Entonces, se dice que la trampa (la impureza en éste caso) es muy eficiente. Como no es así, es decir como no hay un aumento en la coloración entonces la impureza (de K^{+}) no esta funcionando como una trampa (ni tampoco el campo deformación).

Cristal	Catión Remplazado	ΔΕ	ΔE _{Total}
Nacl	Li ⁺	~14.83	-12.49
KCL	Na ⁺	-17.77	~11.61
NaCL	K ⁺	+29.17	+21.74
KBr#	Li ⁺	-24.09	-16.39
KBr#	Na ⁺	-16.00	-10.45
KBr"	Rb ⁺	+9.52	+6.03

*Sistemas estudiados por Giuliani (30).

TABLA VI.- CAMBIO EN LA ENERGIA TOTAL Y ENERGIAS DE REFULBION, DEBIDAB AL REMPLAZAMIENTO ALCALINO, Exilocaloríos/mol de ion remplazado;

El caso contrario lo tenémos con el ión de Na[†] que sustituye al K[†]. Esto es, los parimetros de relajación son pequeños y sus magnitudes decaen más lentamente con el aumento de la distancia a partir del tón impureza, lo cual da lugar a una relajación de la red "hacía adentro". Si consideramos, además, que las energias Cla de repulsión y el cambio en la energia total) son negativas, entonces ésto da lugar a que se ejective el atrapamiento del halógeno intersticial por la impuresa de Na[†] porque tanto espacialmente, como energéticamente hay lugar para que se "acomode" el intersticio junto a la impureza.

Una situación muy particular se presenta con el Li⁺ ya que las magnitudes de los parámetros de relajación manifiestan ser los más pequeños y una relajación "hacia adentro" mayor que en el caso anterior (ver las nuevas coordenadas de las capas ionicas correspondientes). Respecto a éste último caso, se sabe que el Li⁺ tiende a formar agregados de dos, tres o más átomos y que además pueden estar ocupando sitios intersticiales, debido a la magnitud del tamaño del átomo de Li⁺. Así si al irradiar se están formando Lítios intersticiales y aglomerados de Li⁺ y la coloración está disminuyendo. Se puede concluir, entonces, que existe una alta ineficiencia al atrapamiento de los intersticiales halógenos por dichos aglomerados, o bién se está alterando de alguna manera específica el mecanismo primario de coloración.

APENDI CE

DEFECTOS SCHOTTKY

En el cero absoluto de temperatura, los atomos (o tones o moléculas) de un sólido se ordenan en forma completamente regular en una estructura cristalina. A medida que se incrementa la temperatura, la agitación térmica introduce varios tipos de irregularidades. En primer lugar, provoca vibraciones de los atomos alrededor de sus posiciones de equilibrio en la estructura. Obbido a los efectos de la Mecanica Cuántica, ocurren pequeñas vibraciones incluso a T=0°K). Ademas, los alomos pueden desplazarse totalmente, partiendo de sus posiciones en el cristal, emigrando hacia cualquier parte y dejando vacantes esas posiciones. Estos son los llamados defectos Schotthy; en estos los atomos desplazados que provocan las vacancias, emigran hacia la superficie del cristal.

Para un cristal en equilibrio térmico, se desea averiguar en que forma el número de defectos Schottky depende de la temperatura del cristal. AT=0°K se sabe que no habra defectos. A medida que aumenta la temperatura aumentará gradualmente el número de defectos. Los átomos que se encuentran en el interior de la estructura cristalina, tienen una energia más baja que los átomos que se encuentran en la superficie, ya que en el interior los átomos estan ligados a un gran número de átomos que los rodean. Sea la energia de formación de un defecto Schottky; o sea, la energia de un átomo en la superfície, medida relativa a la energia de un átomo interior (La energia de un átomo interior (La energia de un átomo interior Schotta). Considere ahora un cristal que esta formado por N átomos y que posee n defectos Schottky. La energia asociada con estos defectos esta dada por:

E = n %

Esta expresión supone que las posiciones vacantes estan bien separadas, de manera que cada vacancia está rodeada por una estructura cristalina bien ordenada. Sólo en este caso puede atribuirse una energia definida à a cada vacancia. Por tanto se supondra que n

pequeño comparado con el número de Atomos. Verificarémos que esta condición se satisface.

A continuación, requeriremos el peso estadistico $\Omega(n)$ del macroestado de un cristal formado por N átomos y que posee n defectos Schottky. En dicho cristal, los N átomos están distribuidos sobre (N+n) posiciones de la estructura. Esto puede hacerse en $\binom{N+n}{n}$ formas. Esto es, existen $\binom{N+n}{n}$ maneras de elegir las n posiciones que van a permanecer vacias, de la localidad de (N+n). Por consiguiente, se tiene:

$$\Omega C_{1} = \begin{bmatrix} N \leftarrow T_{1} \\ P_{N} \end{bmatrix} = \frac{C_{1} N \leftarrow T_{1} + T_{1}}{T_{1} N_{1}} \dots A.1$$

Esta expresión de-sprecia cualquier dependencia de las propiedades del cristal... de N Atomos y n vacancias, respecto a su forma ya que simple-mente se han tomado, (N+n) posiciones vecinas en total, sin considerar la forma que constituyen. La MecAnica Estadistica nose define a la entropia de un sistema en el macroestado (E,V,N,a) por la ecuación:

S.A... CO,N,V,EXD = k ln (XE,V,N,c)... A. 2

donde E es la energia del sistema, V es el volumen y N el número de moléculas; y a son otras variables, k es la constante de Boltzmann. De ahi que la entropia asociada al desorden resultante de los defectos Schottky està dadad por:

$$SC_n = k \ln \Omega C_n \times k \ln \frac{(n+n)}{\ln \ln n} \dots SC_n \times C_n \times C_n$$

Veamos el problema con más detalle. Se está considerando a la energia y a la entropia asociadas únicamente por los defectos Schottky. Sin embargo el cristal posee otros "factores" tales como el movimiento de vibración. Pero cada uno de estos factores posee su energia y entropia propias y ademas interactúan muy debilmente. De ahi que al calcular la energia y la entropia de cada uno de ellos puede considerarse por separado como si existiera por si mismo. Obviamente, existe una ligera interacción entre estos diferentes factores y es por lo que se llega al equilibrio térmico. En nuestro problema podemos considerar, por ejemplo, el movimiento de vibración y los defectos Schottky como esos diferentes factores que interactúan debilmente.

Tenemos un sistema aislado (el cristal), dividido en dos partes que llamaremos subsistemas, i (el movimiento de vibración) y 2 (los defectos Schottky) con subindices correspondientes para la energia, el volumen y el número de particulas en cada subsistema. Tenemos asi:

 $E_1 + E_2 = E_1 \dots A_n = B_n$

V4 + V2 = V. . . A. 5b

N1 + N2 = N. . . A. 5c

donde E, V, y N son fijos. Vamos a suponer que esta división particular de la energia, etc., entre i y 2 no corresponde al equilibrio. Para que se establesca el equilibrio por si mismo, los dos subsistemas deben ser capaces de interactuar apropiadamente. En particular, es escencial que pueda ocurrir intercambio de energia. Esto significa que la energia del sistema combinado no puede escribirse en la forma A.5a, como la suma de dos energias "particulares" para los dos subsistemas. Debe haber una energia de interacción %. dependente de amieno subsistemas interaction muy debilmente; esto es %cEi y %cEz. En este caso se puede escribir con bastante exactitud la energia lotal en la forma A.5a. Pero sucede que, para esas

interacciones debiles, tarda mucho en establecerse el equilibrio. Esto no tiene consecuencia alguna, ya que no se esta intentando estudiar la rapidéz de los procesos sino que simplemente se estan considerando artificios para estudiar los sistemas en equilibrio.

Para cada división de E, V y N entre los dos subsistemas. de acuerdo con las ecuaciones A.5, se tiene:

$$\Omega(\mathbf{E}_{1}\mathbf{v}_{1}\mathbf{v}_{2}\mathbf{v}_{2}\mathbf{x}_{3}\mathbf{v}_{3}\mathbf{v}_{3}\mathbf{v}_{4}\mathbf{v}_{1}\mathbf{v}_{2}\mathbf{v}_{2}\mathbf{v}_{3}\mathbf{$$

Aqui Ω es el peso estadístico del subsistema 1 en el macroestado específicado por (Ei,Vi, Ni). De igual forma para Ω el primer miembro de la ec. A.6 Ω, es el peso estadístico del sistema compuesto con esta división de la energia, etc.. La ec. A.6 afirma el hecho obvio de que cualquier microestado del subsistema 1 puede combinarse con cualquier microestado del subsistema dos. Debido a las condiciones A.5 que actúan como restricciones sobre las variables, Ei, Ei, Vi, Vi, Ni y Ni, no pueden elegirse todas libremente. Se están tomando Ei, Vi, y Ni como variables independientes, como se indica en el primer miembro de A.6. Estas son las que corresponden a las cantidades

denominadas a en la presentación general.

De la ec. A.3 quede reescribirse la ec. A.6 como:

$$SCE,V,N,E_1,V_1,N_1,0 = SiCE_1,V_1,N_10 + SiCE_2,V_2,N_20...A.7$$

donde Si, Sz y S son las entroplas de los subsistemas y el sistemacombinado. A partir del principio, de la entropla de Clausius, se obtiene la condictón de equilibrio para el sistema, maximizando la entropla. Por lo tanto, de la ec. A.6, tenemos:

y, debido a la ec. A.5a

A. 9

la ec. A.8 es la condición para el equilibrio térmico; (esto es, que no hay transferencia de calor entre los dos subsistemas). En otras palabras, los dos subsistemas deben estar a la misma temperatura; ($\partial Si/\partial Ei$) debe ser una medida de la temperatura del subsistema t (t=1 ó 2). Esto puede usarse para definir una temperatura absoluta T_{ij} (t=1,2) para cada subsistema, por medio de:

$$\frac{\partial S_i}{\partial E_i v_{i,Ni}} = \frac{1}{T_i} \qquad \ell=1,2 \qquad \dots A.10$$

Por lo tanto, para que un cristal estéen equilibrio termodinámico, la temperatura T estará dada por la ec. A.10; esto es:

$$\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial E} = \frac{dS(n)}{dn} \cdot \frac{dn}{dE} = \frac{1}{8} \cdot \frac{dS(n)}{dn}$$
 A.11

el último paso se deduce a partir de E=n%.

Ahora, para obtener dSCnJ/dm, se usa la formula de Stirling para la función factorial.

lo cual se cumple para noi. De aqui se obtiene:

$$\frac{1Cn+nJ}{C(1n!n-1)Cn+nJ} = k \frac{1Cn+nJ}{\ln \ln n} = CnJS$$

de aqui tenemos :

$$\frac{dS(n)}{dn} = k [-ln n + ln (N + n)] = k ln \frac{N+n}{n}$$

y de la ec. A.11 tenemos:

$$\frac{1}{T} = \frac{k}{8} \ln \frac{N + n}{n}$$

esto se puede expresar asi :

$$\frac{1}{kT}\ln \frac{N+n}{n}$$

tomando exponenciales y resolviendo para n. tenemos:

n = N exp (-18/kT)

BIBLIOGRAFIA

- 1). Wert & Thomson. Physics of Solids, Second Edition.

 HcGraw-Hill. Kogakusha.
- 2). Jordan J. Harkham. <u>Fisica del Estado Solido</u>. Suplemento 8, <u>Centros F en Halogenuros Alcalinos</u>. Ed. Academic Press., New York and London. 1986.
- Adrianus J. Dekker. <u>Solid State Physics</u>. Macmillan Press LT ed. 1981.
 - 4). Yves Farge, Marco P. Fontana. <u>Electronic and Vibrational</u>
 Properties of Point Defects in Ionic Crystals.
 - 5). James H. Crawford, Jr. Adv. Phys. 17, 93 (1968).
 - Gordon, R. B. and Nowick, A. S., Phys Rev., <u>101</u>, 977.
 1956.
 - Varley, J. H. O., Nature London <u>174</u>, 886. 1954a; J. Nucl. Eng. <u>1</u>, 130. 1954b; J. Phys. Chem. Solids <u>23</u>, 985. 1962.
 - 8). Williams, F. E., Phys. Rev. 126, 70. 1962.
 - 9). Hersh, H. N., Phys Rev. 148, 928. 1966.
 - 10). D. Pooley Proc. Phys. Soc., 1966 vol. 87, 245.
 - E. Kotomin, I. Fabrikant, and I. Tale. J. Phys. C: Solid State Phys., Vol. 10, 1977.
 - K.J. Kao and H. H. Perlman. Phys. Rev. (1979) B, 19, 1196.
 - G. Guillot and A. Novailhat, Phys. Rev. (1979) B, 19, 2295.
 - 14). Waite, T. R., Phys. Rev. 107, 463, 1957.
 - J. D. Comins and B. O. Carragher, Phys. Rev. 1981 B, 24, 283.
 - M. Aguilar, F. Jaque and F. Agullo-Lopez. Radiation Effects. 1982. Vol. 61, pp. 215-222.

- 17). Hobbs, L. W., Hughes A. E. and D. Pooley. Proc. Roy. Soc. A 332, 167, 1979.
- F. Agulló-López, F. J. López and F. Jaque. Cryst. Latt. Def. and Amorph. Hat., 1982, Vol. 9, pp. 227-252.
- S. Ramos B., J. Hernández A., H. Hurrieta S., and J. Rubio
 F. Jaque. Physicaal Review B. Volume 31, Number 12, 15 junio 1985.
- J. Rubio O., J. Hernández A., H. Murrieta S. and S. Ramos
 Physical Review B., Volume 34, Number 8, 15 October 1986.
- J. Rubio O., H.C. Flores, H. Hurrieta S. and J. Hernández
 A., T. Jaque and F.J. López, Phys. Rev. 1982, B, 26, 2199.
- 22). James H. Crawford, Jr. and Laurence H. Slifkin. Point Defects in Solids. Vol. 1. General an Ionic Crystals. Ed. Plenum Press-New York-London, 1972. Cap. 4, pags. 201-283.
- 23). Hersh, H. N., Phys. Rev., 1966, 148, 928.
- Huñoz F. A., Procesos de Transferencia de Energia entre impurezas metálicas divalentes incorporadas en cristales iónicos. Tesis Doctoral. UAH-Iztapalapa. Julio, de 1988.
- A. H. Stoneham, Theory of Defects in Crystals, Clarendon Press, Oxford (1975).
- G. H. Muñoz and J. O. Rubio. J. Phys. C: Solid State Phys. 21 (1988) 847-861.
- J. O. Rubio, H. G. Aguilar, F. J. López, H. Galon, J. García-Solé and h. S. Hurrieta. J. Phys. <u>C</u>: Solid State Phys., 15 (1982) 6113-6128.
- 28). G. Giuliani. Phys. Rev. B Vol. 2, No. 2 1970.
- G. Giuliani, A. Gustinetti and A. Stella. Phys. Rev. B Vol. 4 No. 6, 2054, 1971.
- 30). Y. Kondo and M. Hirai. J. Phys. Soc. Japan 30, 1765, 1971.
- Hasahiro Saidoh and Noriaki Itoh. Journal of the Physical Society of Japan, Vol. 29 No. 1 156 1970.
- 32). M. N. Kabler, Point Defects in Solids, Ed. by J. H. Crawford Jr. and L. H. Slifkin, Plenum Press, NewYork, pp.

327-380. 1972.

- 33>. D. Schoemaker, J. Physique 37, C7-63, 1976.
- 34). Thomas B. Douglas. The Journal of Chemical Physics. Vol. 45, Num. 12, 15 December 1966.